



**KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG**

1026 Budapest, Riadó u. 5.

1525 Pf.: 166.

Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592

Elektronikus kapcsolattartás: kozbeszerzes.hu

Az ügy iktatószáma: D.361/28/2018.

A tanács tagjai: Dr. Dajka Gabriella közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Gulyás Richárd közbeszerzési biztos, Dr. Horváth Éva közbeszerzési biztos

A kérelmező: JEOL (Europe) SAS
(1, Allée de Giverny, 78290 Croissy-Sur-Seine,
Franciaország)

A kérelmező képviselője: Dr. Dull Attila
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Az ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
(Pécs, Vasvári Pál u. 4.)

Az ajánlatkérő képviselője: Dr. Zámbó Balázs jogtanácsos

Az egyéb érdekelt: Carl Zeiss Technika Kft.
(Budaörs, Neumann János u. 3.3.)

Az egyéb érdekelt képviselője: König és Orosz Ügyvédi Iroda. Dr. Orosz Dániel
ügyvéd
(Budapest, Varsa u. 5.)

A beszerzés tárgya, értéke: „Eszközbeszerzés a Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése GINOP-2.2.1-15-2017-00102 pályázat keretein belül a Pécsi Tudományegyetem részére” - 3. rész – 59.913.333.-Ft

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T - o t.

A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelemnek helyt ad és megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 69. § (1) és (2) bekezdésére és a 77. § (4) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (3) bekezdését.

A Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő közbeszerzési eljárás 3. részét lezáró döntését.

A Döntőbizottság az ajánlatkérővel szemben 600.000.-Ft, azaz hatszázezer forint bírságot szab ki.

A Döntőbizottság felhívja az ajánlatkérőt, hogy a bírság összegét a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közbeszerzési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01040360-00000000 számú központosított beszedési számlájára átutalással teljesítse.

A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül fizessen meg a kérelmező részére 299.567.-Ft, azaz kétszázkilencvenkilencezer-ötszázhatvanhét forint igazgatási szolgáltatási díjat. A jogorvoslati eljárás során felmerült egyéb költségeiket a felek maguk viselik.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a Fővárosi Törvényszék előtt közigazgatási per indítható, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, de kizárólag a Döntőbizottsághoz kell elektronikus úton benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására/közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

I N D O K O L Á S

A jogorvoslat alapjául szolgáló tényállás

1. Az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerinti nyílt eljárást megindító ajánlati felhívása 2018.05.18-án került feladásra az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2018/S 095-215381 számon. A felhívás 2018/S 120-273331 számon módosításra került.

2. A felhívás II.1.4) pontjában a közbeszerzés meghatározása körében rögzítésre került, hogy eszközbeszerzést kíván az ajánlatkérő megvalósítani a „Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése GINOP-2.2.1-15-2017-00102 pályázat” keretein belül a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, az alábbi bontásban:

1. ajánlati rész: DSC kaloriméter
2. ajánlati rész: HPHT reométer (viszkóziméter)
3. ajánlati rész: Pásztázó elektronmikroszkóp (FEG-SEM) EDS/EDX detektorral

3. A felhívás II.1.6) pontjában a részekre vonatkozó információk között ajánlatkérő közölte, hogy az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

4. A felhívás I.2.4) pontjában a 3. részre az ajánlatkérő meghatározta, hogy 1 db pásztázó elektronmikroszkópot kíván (FEG-SEM) beszerezni EDS/EDX detektorral a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

Pásztázó elektronmikroszkóp (scanning electron microscope, SEM). A műszer alkalmas kell, hogy legyen nanométeres felbontással bármilyen minta felületének morfológiai és elemi összetételi vizsgálatára, nemcsak nagyvákuumban, hanem kisvákuumban is. A mikroszkóp tartozéka egy energiadiszperzív röntgenspektrométer (EDS), amellyel a mikrométerű fázisok elemi összetétele meghatározható. A megajánlott elektronmikroszkóp a tartozékaival együtt új gyártású, nem használt készülék, amely funkcionálisan működőképes rendszert alkot. Az ajánlati ár magában foglalja a szállítás, üzembe helyezés, a felhasználói szintű oktatás költségét 8 órában, min. 3 fő részére, valamint a szoftver felhasználói jogának biztosítását. Jótállás: a sikeres átadás-átvételtől számított 12 hónap teljes körű jótállás.

5. A felhívás II.2.5) pontjában az értékelési szempontokként a következőket határozta meg az ajánlatkérő a 3. részben:

Részszempont		Súlyszám
3.1.	Nettó Ajánlati Ár (amely magában foglalja a szállítás, üzembe helyezés, valamint a felhasználói szintű oktatás költségét 8 órában, min. 3 fő részére)	60
3.2.	Képfelbontás legjobb értéke nagyvákuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsítófeszültség mellett (min. 2 nanométer – max. 1 nanométer)	10
3.3.	Képfelbontás legjobb értéke alacsonyvákuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsítófeszültség mellett (min. 2 nanométer – max. 1 nanométer)	5
3.4.	Nedves vagy nem vákuumtűrő minták vizsgálatához 4000 Pa kamranyomás is elérhető (igen/nem)	5
3.5.	Azonnali pontelemzés a szekunder és visszaszórt élő képen második szoftver megnyitása nélkül (igen/nem)	5
3.6.	A vizsgált terület valós idejű elemanalízise a SEI/BEI megfigyelés közben (kép, spektrum, analízis eredménye és az elemek egyszerre megjelenítettek) (igen/nem)	5
3.7.	Folyamatos nagyítás optikai képről (pl. navigációs kép) az elektronmikroszkópos képig (igen/nem)	5
3.8.	3 év garancia a fényforráson (igen/nem)	3
3.9.	Zárt rendszerű hűtőberendezés (igen/nem)	2

6. Az ajánlatkérő megadta az ajánlattételhez szükséges további előírásait, meghatározta az eljárási határidőket, továbbá a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátotta a beszerzendő eszközök műszaki leírását, továbbá az értékelésre vonatkozó további részletes előírásait.

7. A 3. részre vonatkozó műszaki leírás a következőket tartalmazta.
Pásztázó elektronmikroszkóp (scanning electron microscope, SEM). A műszer alkalmas kell, hogy legyen nanométeres felbontással bármilyen minta felületének morfológiai és elemi összetételi vizsgálatára, nemcsak nagyvákuumban, hanem kisvákuumban is. A mikroszkóp egy energiadisziperzív röntgenspektrométer (EDS), amellyel a mikroméretű fázisok elemi összetétele meghatározható. A megajánlott elektronmikroszkóp a tartozékaival együtt új gyártású, nem használt készülék, amely funkcionálisan működőképes rendszert alkot.

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás
Elektronágyú: nagy áramú, alacsony zajú Schottky-emitter	igen
Gyorsítófeszültség: Változtatható az 0,5–30 kV tartományban	Igen
Nyalábáram: folyamatosan szabályozható és eléri a 20 nA-t	Igen
Vákuumrendszer: Mind nagyvákuumban, mind alacsonyvákuumban üzemeltethető a mikroszkóp: nagyvákuum módban legfeljebb 10^{-3} Pa nyomás; 130 Pa mintakamra nyomás is elérhető.	Igen

Felbontás (30 kV gyorsítófeszültségnél): -nagyvákuum módban legfeljebb 1,5 nm; -alacsonyvákuum módban legfeljebb 2 nm. Felbontás 1 kV gyorsítófeszültségnél, -nagyvákuum módban legfeljebb 4,5 nm.	Igen
Elektronoptika és pásztázó elektronika: -külső mágneses tértől mentes objektívlencse; -változtatható pixelsűrűségű pásztázás -driftkorrigált képintegrálás	Igen
Mintaasztal, mintatartók: -x-y irányban legalább 80×60 mm, z irányban legalább 40 mm mozgást engedő, dönthető és forgatható, mind az 5 tengelyen motorizált, eucentrikus és/vagy kompucentrikus mintaasztal	Igen
Detektorok: -Everhart-Thornley SE detektor; -alacsonyvákuumhoz SE detektor; -alacsony gyorsítófeszültségen is használható többszegmensű szilárdtest-BSE detektor.	Igen
Mintakamra: -belső átmérő legalább 200 mm -max. mintamagasság legalább 60 mm -max. minta-tömeg legalább 500 gramm -portok száma ≥ 10 db	Igen
EDS rendszer: A Be és annál nehezebb elemek detektálására alkalmas, könnyűelemes ablakkal ellátott, folyékony, nitrogén nélkül üzemeltethető Si drift detektor (SDD). -legalább 25 mm² aktív felület; -legfeljebb 129 eV felbontás (Mn Kα csúcsnál, 100000 beütésszám/sec mellett); -többpontos, vonal menti elemzés és ultragyors elemterképezés; -a rendszerhez tartozó munkaállomás, kliens-szerver architektúra, szoftver. -automatikus kalibráció;	Igen
Egyéb feltételek kompresszor sűrített levegőhöz (amennyiben a rendszerhez szükséges); -mikroszkóp vezérlés 64 bit Windows operációs rendszer alatt (munkaállomással és egy 24" LCD monitorral).	Igen
Szállítás, üzembe helyezés, kezelők betanítása: szállítás, üzembe helyezés, átvétel a garantált paraméterek teljesítésekor; egynapos (8 órában) kezelői betanítás akár több (minimum 3 fő) személy részére	Igen
Garancia: A sikeres átadás-átvételtől számított 1 év teljes körű helyszíni garancia, beleértve a meghibásodott alkatrészek cseréjét.	Igen

8. A közbeszerzési dokumentációban a 3.2. értékelési részszempont tekintetében az ajánlatkérő közölte, hogy a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. A képfelbontás legjobb értéke nagyvákuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsítófeszültség mellett alsó határaként 1 nanométert (legkedvezőbb), felső határaként 2 nanométert (legkedvezőtlenebb) határozott meg, mely alapján a 2 nanométer megajánlás 0 pontot kap, az 1 nanométer vagy az annál kedvezőbb megajánlás egyaránt 10 pontot kap. A további ajánlatok a maximális (legkedvezőtlenebb) és minimális (legkedvezőbb) ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva

- 3 (három) tizedes jegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva-kapnak pontot. A 2 nanometert meghaladó megajánlásokat érvénytelenné nyilvánítja.

9. Az ajánlatok értékelése a 3.5. és a 3.7. értékelési részszempontok esetében amennyiben az ajánlattevő vállalja az előírt műszaki paraméter megvalósítását, akkor 10 pontot kap, amennyiben nem, 0 pontot kap. Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termék.

10. Az ajánlatkérő a felhívás VI.3) pontjában előírta, hogy a benyújtott ajánlatban csatolni kell a megajánlott termék paramétereit, tulajdonságait bemutató műszaki leírást.

11. Az ajánlatkérő a gazdasági szereplők által feltett kiegészítő tájékoztatáskérésekre – többek között 2018.06.13-án – a következőket közölte.

„3. kérdés (3. rész)

3.2. Képfelbontás legjobb értéke nagyvákuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsítófeszültség mellett.

A felbontás mérésére a gyártók eltérő módszereket alkalmaznak, mint pl. az ISO kompatibilis derivatív eljárás, vagy a 25/75% illetve 35/65% aránnyal végzett szél kontrasztos meghatározás. Ezek a mérések ugyanazon kép esetében eltérő számeredményeket mutathatnak.

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt a felbontás mérésének meghatározására, illetve az ajánlatban mikroszkópos képpel történő igazolás előírására.

Válasz:

A felbontás mérése az ISO/TS 24597:2011 szerint értelmezendő, lásd: (1.) Microbeam analysis - Scanning electron microscopy - Methods of evaluating image sharpness, ISO/TS 24597:2011(E) és (2.) Microsc. Microanal. 22 (Suppl 3), 2016. doi:10.1017/S1431927616003998.”

5. kérdés (3. rész)

„3.5. Azonnali pontelemzés a szekunder és visszaszórt élő képen második szoftver megnyitása nélkül.

Ez azt jelenti, hogy ugyanazon szoftver kezdje a képalkotást és az EDS analízist?

Válasz:

Igen, ugyanazon szoftver kezelje a képalkotást és az EDS analízist.”

6. kérdés (3. rész)

„3.6 .A vizsgált terület valós idejű elemanalízise a SEI/BEI megfigyelés közben (kép, spektrumanalízis eredménye és az elemek egyszerre megjelenítettek).

Ebben a pontban az EDS spektrumnak egy időben kell megjelennie az élő képen kijelzett képpel?

Válasz:

Igen, ebben a pontban az EDS spektrumnak egy időben kell megjelennie az élő képen kijelzett képpel.”

7. kérdés (3. rész)

„3.7. Folyamatos nagyítás optikai képről (pl. navigációs kép) az elektronmikroszkópos képig
Tehát a funkció folyamatos átmenetet jelent optikai és elektronmikroszkópos nagyítás között ugyanazon gomb használatával?

Válasz:

Igen, a funkció folyamatos átmenetet jelent optikai és elektronmikroszkópos nagyítás között ugyanazon gomb használatával.”

12. Az ajánlattételi határidőben a 3. rész tekintetében az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:

- Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.

Nettó Ajánlati Ár HUF (amely magában foglalja a szállítás, üzembe helyezés, valamint a felhasználói szintű oktatás költségét 8 órában, min. 3 fő részére): 62 500 000

Képfelbontás legjobb értéke nagyvákuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsítófeszültség mellett (min. 2 nanométer – max. 1 nanométer): 1

Képfelbontás legjobb értéke alacsonyvákuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsítófeszültség mellett (min. 2 nanométer – max. 1 nanométer): 1,3

Nedves vagy nem vákuumtűrő minták vizsgálatához 4000 Pa kamranyomás is elérhető: Igen

Azonnali pontelemzés a szekunder és visszaszórt élő képen második szoftver megnyitása nélkül: Nem

A vizsgált terület valós idejű elemanalízise a SEI/ BEI megfigyelés közben (kép, spektrum, analízis eredménye és az elemek egyszerre megjelenítettek): Igen

Folyamatos nagyítás optikai képről (pl. navigációs kép) az elektronmikroszkópos képig: Nem

3 év garancia a fényforráson: Igen

Zárt rendszerű hűtőberendezés: Igen.

- Carl Zeiss Technika Kft.

Nettó Ajánlati Ár HUF (amely magában foglalja a szállítás, üzembe helyezés, valamint a felhasználói szintű oktatás költségét 8 órában, min. 3 fő részére): 58 196 850

Képfelbontás legjobb értéke nagyvákuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsítófeszültség mellett (min. 2 nanométer – max. 1 nanométer): 1

Képfelbontás legjobb értéke alacsonyvákuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsítófeszültség mellett (min. 2 nanométer – max. 1 nanométer): 2

Nedves vagy nem vákuumtűrő minták vizsgálatához 4000 Pa kamranyomás is elérhető: Nem

Azonnali pontelemzés a szekunder és visszaszórt élő képen második szoftver megnyitása nélkül: Igen

A vizsgált terület valós idejű elemanalízise a SEI/ BEI megfigyelés közben (kép, spektrum, analízis eredménye és az elemek egyszerre megjelenítettek): Igen

Folyamatos nagyítás optikai képről (pl. navigációs kép) elektronmikroszkópos képig: Igen

3 év garancia a fényforráson: Igen

Zárt rendszerű hűtőberendezés: Igen

Az ajánlattevő szakmai ajánlata a következőket tartalmazta:

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Elektronágyú: nagy áramú, alacsony zajú Schottky-emitter	igen	igen
Gyorsítófeszültség: Változtatható az 0,5–30 kV tartományban	Igen	0.02 kV-30 kV
Nyalábáram: folyamatosan szabályozható és eléri a 20 nA-t	Igen	igen

Vákuumrendszer: Mind nagyvákuumban, mind alacsonyvákuumban üzemeltethető a mikroszkóp: nagyvákuum módban legfeljebb 10^{-3} Pa nyomás; 130 Pa mintakamra nyomás is elérhető.	Igen	igen, <2x10 ⁻⁴ Pa, max. 133Pa
Felbontás (30 kV gyorsítófeszültségnél): -nagyvákuum módban legfeljebb 1,5 nm; -alacsonyvákuum módban legfeljebb 2 nm. Felbontás 1 kV gyorsítófeszültségnél, -nagyvákuum módban legfeljebb 4,5 nm.	Igen	Igen, 1.0 nm Igen, 2.0 nm igen:1.8 nm
Elektronoptika és pásztázó elektronika: -külső mágneses tértől mentes objektívlencse; -változtatható pixelsűrűségű pásztázás -driftkorrigált képintegrálás	Igen	igen igen igen
Mintaasztal, mintatartók: -x-y irányban legalább 80×60 mm, z irányban legalább 40 mm mozgást engedő, dőnhető és forgatható, mind az 5 tengelyen motorizált, eucentrikus és/vagy kompucentrikus mintaasztal	Igen	igen, XY=125x125mm, Z=50mm, dőntés, forgatás
Detektorok: -Everhart-Thornley SE detektor; -alacsonyvákuumhoz SE detektor; -alacsony gyorsítófeszültségen is használható többszegmensű szilárdtest-BSE detektor.	Igen	igen
Mintakamra: - belső átmérő legalább 200 mm - max. mintamagasság legalább 60 mm - max. minta-tömeg legalább 500 gramm - portok száma ≥ 10 db	Igen	igen, 365 mm átmérő, 275 mm max minta magasság, 5 kg tömegig terhelhető
EDS rendszer: A Be és annál nehezebb elemek detektálására alkalmas, könnyűelemes ablakkal ellátott, folyékony, nitrogén nélkül üzemeltethető Si drift detektor (SDD). -legalább 25 mm ² aktív felület; -legfeljebb 129 eV felbontás (Mn K α csúcsnál, 100000 beütésszám/sec mellett); -többpontos, vonal menti elemzés és ultragyors elemterképezés; -a rendszerhez tartozó munkaállomás, kliens-szerver architektúra, szoftver. -automatikus kalibráció;	Igen	igen,30mm 2, 129eV, igen, minden más feltétel teljesül
Egyéb feltételek kompresszor sűrített levegőhöz (amennyiben a rendszerhez szükséges); -mikroszkóp vezérlés 64 bit Windows operációs rendszer alatt (munkaállomással és egy 24" LCD monitorral).	Igen	igen
Szállítás, üzembe helyezés, kezelők betanítása: szállítás, üzembe helyezés, átvétel a garantált paraméterek teljesítésekor; egynapos (8 órában) kezelői betanítás akár több (minimum 3 fő) személy részére	Igen	Igen,
Garancia: A sikeres átadás-átvételtől számított 1 év teljes körű helyszíni garancia, beleértve a meghibásodott alkatrészek cseréjét.	Igen	igen

Az ajánlatban a következő termékleírás került benyújtásra a megajánlott ZEISS Sigma elektronmikroszkóp tekintetében.

„A Sigma család téremissziós szkennig elektronmikroszkópjai a mintákról igen magas követelményeket teljesítő képeket szolgáltatnak, ugyanakkor minden követelményt kielégítő analitikai feladatokat is teljesítenek.

A Sigma család két tagja, a *Sigma 300* és a *Sigma 500* közötti választás lehetővé teszi Önnek a legjobb döntést céljának elérésére.

A kiváló képek készítésének struktúráját és produktivitását az intuitív *4-lépéses munkafolyamat* teszi lehetővé. Alkalmazásával megvalósíthatja a legkedvezőbb idő – képkészítés folyamatot: lecsökkentheti a betanulási időt a feladat tökéletes begyakorláshoz. A Sigma rendszerekben az osztályában legjobb EDS geometria növeli analitikájának produktivitását, különösen a besugárzásra érzékeny minták esetén. Az analitikai eredményeket a szokásos próbaáramok felével és időben kétszeres sebességgel érheti el. A detektorok a mintákhoz közelebb vannak elhelyezve, amivel árnyékmentes analitikát lehet teljesíteni. A Sigma-kban megvalósított rövid 8,5 mm-es munkatávolság és a 35°-os beállítási szög alkalmazása is segíti az analitikai vizsgálatok eredményességét.

A készülékekben a több mint húsz éve megalkotott Gemini technológia alkalmazása komplett és nagy hatásfokú detektálást, kiváló felbontást nyújt. A Gemini objektív lencse az elektrosztatikus és a mágneses mezők kombinálásával maximalizálja az optikai leképezés teljességét és minimumra csökkenti az elektromos/mágneses mezőknek a mintára alkalmazott hatását.

(...)

Az alkalmazható detektorok sokasága a Sigma készülékek sokoldalú felhasználását szolgálja: többek között biológiai preparátumok, részecskék, felületek, nanostruktúrák, vékony filmek, bevonatok, vékony rétegek vizsgálhatók. A Gemini detektálás hatásos jelérzékelést valósít meg az SE szekunder elektron detektorok és/vagy a BSE visszaszórt elektron detektorok akár együttes alkalmazásával. Az úgynevezett InLens detektor az optikai tengelyben kerül felhasználásra, amely csökkenti beszabályozásának szükségességét és minimalizálja az idő-leképezés viszonyt.

A Gemini Beam booster technológia garantálja minimális méretű minta alkalmazását magas jel/zaj viszony és ultrakicsiny gyorsító feszültség esetén is.

A ZEISS Sigma szkennig elektronmikroszkóp család a következő detektorok és tartozékok alkalmazását teszi lehetővé:

Detektorok és tartozékok	A detektorok/tartozékok felhasználhatósága	Sigma 300	Sigma VP 300	Sigma 500	Sigma VP 500
InLens SE detektor	Nagy felbontás, topografikus leképezés	+	+	+	+
InLens Duo detector	Nagy felbontás, topografikus vagy kevert leképezés	x	x	o	o
ETSE detektor	Magas vákuumban topografikus leképezés nagy munkatávolság alkalmazásával	+	+	+	+
VPSE-G4 detektor	Negyedik generációs változtatható nyomású SE detektor	x	+	x	+
C2D	Áram detektor nagy teljesítményű változtatható nyomású leképezéshez	x	o	x	o
AsB detektor	Kevert és kristályorientációs leképezéshez	o	o	o	o
4Q HDBSD detektor	4 kvandrású nagy teljesítményű BSE detektor kevert leképezéshez	o	o	o	o
5S HDBSD detektor	5 szegmensű nagy felbontású BSE detektor különösen alacsony kV-os kevert leképezéshez	o	o	o	o

YAG-BSD detektor	YAG kristályos szcintillációs BSE detektor gyors, könnyen használható kevert leképzéshez	o	o	o	o
BSD4 detektor	BSE detektor 4 parallel kimenettel valós idejű 3D felület metrológiai képességgel	x	x	o	o
MMSTEM detektor	Multimódusú STEM detektor biológiai és vékony film tárgyak átmenőfényes leképzéséhez	o	o	o	o
aSTEM detektor	Gyűrűs STEM detektor átmenőfényes leképzéshez	x	x	o	o
CL detektor	Katódlumineszcens detektor	o	o	o	o
3DSM	Mintájáról 3D képeket generál nyomon követhető felületi metrológiai mérésekkel	o	o	o	o
Airlock	Minták gyors behelyezése 80 mm átmérőig	o	o	o	o
Large Airlock	Minták gyors behelyezése 130 mm átmérőig	x	x	o	o
Plasma Cleaner	Eltávolítja a szénhidrogén szennyeződést a nagy felbontású leképzéshez	o	o	o	o
3View	Biológiai minták sorozat leképzéséhez	x	o	x	x
EBSD detektor	Visszaszórt elektron diffrakciós detektor mikrostrukturális kristallográfiás analízishez	o	o	o	o
EDX detektor	Energia diszperzív X-sugár analízis nagy felbontású kevert analízishez	o	o	o	o
WDS detektor		Hullámhossz diszperzív spektroszkópia alacsony artefact nagyfelbontású kevert analíziséhez		o	

Jelölések: + standard detektorok/ tartozék

o opciósan beszerezhető detektorok/tartozékok

x nem beszerezhető (nem alkalmazható) detektorok/tartozékok

A Sigma szkennung elektronmikroszkópok műszaki paraméterei:

ZEISS Sigma 300	
Elektron forrás	Schottky termikus téremisszió
Felbontás @ 15 kV	1,2 nm
Felbontás @ 1 kV	2,2 nm
Visszaszórt elektron detektor	HDBSD
Maximális szkennelési sebesség	100 ns/pixel
Gyorsító feszültség	0,02 ... 30 kV
Nagyítás	10x ... 1.000.000x
Mintaáram	4 pA ... 20 nA (4 nA □ 100 nA opcióban)
Kép framek	13 k x 2 k pixel
Kapuk	10
EDS kapuk	2 (1 ajánlott kapu)

Az alkalmazható vákuumok módosítai:

ZEISS Sigma 300	
Nagy vákuum	igen
Változtatható nyomás	2 ... 133 Pa
Asztal típusa	5 tengelyű kompucentrikus
Asztal X irányú mozgatása	125 mm
Asztal Y irányú mozgatása	125 mm
Asztal Z irányú mozgatása	50 mm
Asztal T irányú mozgatása (dőntése)	-10 ... +90 fok
Asztal R irányú mozgatása (forgatás)	360° folyamatosan

A Sigma szkennings elektronmikroszkóp beüzemeltetését, garanciális és garancia időn túli szervizét, karbantartását a CARL ZEISS magyarországi márkaszervize végzi.

- Image-Science Kft.

Nettó Ajánlati Ár HUF (amely magában foglalja a szállítást, üzembe helyezés, valamint a felhasználói szintű oktatás költségét 8 órában, min. 3 fő részére): 60 140 000

Képfelbontás legjobb értéke nagyvákuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsítófeszültség mellett (min. 2 nanométer – max. 1 nanométer): 1,2

Képfelbontás legjobb értéke alacsonyvákuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsítófeszültség mellett (min. 2 nanométer – max. 1 nanométer): 1,5

Nedves vagy nem vákuumtűrő minták Nem vizsgálatához 4000 Pa kamranyomás is elérhető: Azonnali pontelemzés a szekunder és visszaszórt élő képen második szoftver megnyitása nélkül: Igen

A vizsgált terület valós idejű elemanalízise a SEI/ BEI megfigyelés közben (kép, spektrum, analízis eredménye és az elemek egyszerre megjelenítettek): Igen

Folyamatos nagyítás optikai képről (pl. navigációs kép) az elektronmikroszkópos képig: Igen
3 év garancia a fényforráson: Nem

Zárt rendszerű hűtőberendezés: Nem

- JEOL (EUROPE) SAS

Nettó Ajánlati Ár HUF (amely magában foglalja a szállítást, üzembe helyezés, valamint a felhasználói szintű oktatás költségét 8 órában, min. 3 fő részére): 60 120 000

Képfelbontás legjobb értéke nagyvákuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsítófeszültség mellett (min. 2 nanométer – max. 1 nanométer): 1,1

Képfelbontás legjobb értéke alacsonyvákuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsítófeszültség mellett (min. 2 nanométer – max. 1 nanométer): 1,5

Nedves vagy nem vákuumtűrő minták vizsgálatához 4000 Pa kamranyomás is elérhető: Nem
Azonnali pontelemzés a szekunder és visszaszórt élő képen második szoftver megnyitása nélkül: Igen

A vizsgált terület valós idejű elemanalízise a SEI/ BEI megfigyelés közben (kép, spektrum, analízis eredménye és az elemek egyszerre megjelenítettek): Igen

Folyamatos nagyítás optikai képről (pl. navigációs kép) az elektronmikroszkópos képig: Igen
3 év garancia a fényforráson: Igen

Zárt rendszerű hűtőberendezés: Igen

13. Az összegezést 2018. szeptember 26-án küldte meg az ajánlatkérő az ajánlattevők részére. A 3. rész tekintetében érvényes ajánlattevő lett a Carl Zeiss Technika Kft., a kérelmező, az Image-Science Kft. valamint az Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft. Nyertes ajánlattevőként a Carl Zeiss Technika Kft.-t nevesítette.

14. A kérelmező 2018. október 2-án iratbetekintésen vett részt, majd 2018. október 5-én kelt előzetes vitarendezési kérelmében kifogásolta az ajánlatkérőnek a nyertes ajánlattevő 3.2., 3.5. és a 3.7. értékelési részszempontokra adott vállalását, annak elfogadását.

„A 3.2. Képfelbontás legjobb értéke nagyvákuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsítófeszültség mellett 1 nm megajánlás tekintetében az „ajánlatkérő 2018.06.13-i kiegészítő tájékoztatása alapján a felbontást az ISO/TS 245597:2011 szerinti derivatív módon kérte meghatározni. A megajánlott termék (Zeiss Sigma 300) katalógusában (1. sz. melléklet) a felbontási értékeknél a következő adatok találhatók (30. old.):

Zeiss Sigma 300

Schottky fényforrás 1.0 nm

Elektronforrás

Felbontás* 30 kV-on (STEM)

Felbontás * 15 kV-on

1.0 nm 1.6 nm 2.0 nm

Felbontás * 1 kV-on

Felbontás * 30 kV-on (VP mód)

*optimális munkatávon, az üzembe helyezés során, a felbontás az átvételi teszten 1kV-on és 15 kV-on igazolt.

A fenti adatok alapján a 30 kV-os felbontás STEM módban 1,0 nm, ugyanakkor a katalógusban opcionálisnak feltüntetett (detektorlista 1. sz. melléklet 28. old.) STEM detektort nyertes ajánlattevő ajánlati ára nem tartalmazza. A felbontás igazolása a megjegyzés alapján csak 1 és 15 kV-on garantált, így 30 kV-os érték az átvételi teszten nem áll rendelkezésre, a felbontási érték nem igazolható. Az ajánlatból ennek megfelelően nem derül ki, hogy a termék ISO kompatibilis derivatív eljárással 30 kV-on teljesíteni tudja az 1,0 nm felbontást SEM üzemmódban.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a megajánlott Zeiss Sigma 300 nem teljesíti a nyertes ajánlattevő által a 3.2. értékelési szempont tekintetében megjelölt 1 nm értéket.

3.5. Azonnali pontelemzés a szekunder és visszaszórt élő képen második szoftver megnyitása nélkül részszempontra adott igen vállalásnál ez a funkció akkor teljesíthető, ha az FESEM vezérlő operációs rendszere ugyanabban az időben, egyszerre kezeli a pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) az élő kép és az elemanalízis funkciókat.

A Zeiss Sigma VP FESEM használati útmutatója (2. sz. melléklet) 9. oldalán található információk szerint (1.2.1. Software startup) a Sigma 300 a SmartSEM operációs rendszert használja, mely csak a SEM funkciókat vezérli, míg az elemanalízist nem. A Zeiss nem energia diszperzív spektrométer gyártó, a szekunder és visszaszórt élő képen a pontelemzés elvégzésére egy külső EDS gyártó második szoftverét (pl. APEX szoftver) kell megnyitnia.

A kérelmező estében a pásztázást és az EDS analízist egy scan generátor látja el egy szoftver irányításával, míg Zeiss esetében két scan generátorra és két szoftverre van szükség.

A fentiekben hivatkozott felhasználói útmutató releváns részének (9. oldal 1.2.1. pont) felelős fordítása:

„1.2.1 Software Startup

The microscope is controlled entirely by the SmartSEM software suite developed by Zeiss.”

„1.2.1 Szoftver indítása

A mikroszkópot teljes mértékben a Zeiss által kifejlesztett SmartSEM szoftver vezérli.”

A fentiek alapján megállapítható, hogy a megajánlott Zeiss Sigma 300 nem teljesíti a nyertes ajánlattevő által a 3.5. értékelési szempont tekintetében megjelölt feltételeket.

3.7. Folyamatos nagyítás optikai képről (pl. navigációs kép) az elektronmikroszkópos képig részszempontra adott igen válasz tekintetében az ajánlatkérő 2018.06.13-i kiegészítő tájékoztatása alapján, az értékelési szempontban megjelölt funkciót egy gomb használatával kell elérni. Folyamatos nagyítás optikai, vagy navigációs képről az elektronmikroszkópos képig a nagyítás változtatására szolgáló gomb használatával akkor teljesíthető, ha az optikai, vagy navigációs kép és az elektronmikroszkópos kép egymásba beágyazott. Az optikai, vagy navigációs kép nagyítás nélkül (vagy kevesebb, mint 1x nagyítással) kijelzett. A megajánlott termék a katalógusa (1. sz. melléklet) alapján nem tud nagyítani az optikai képről az elektronmikroszkópos képig (x600.000) egy gomb használatával. A katalógus (1. sz. melléklet) 8. oldalán látható kép mutatja be a kamera képét, melyet a lokáció meghatározására

használnak. Ez a kép nem beágyazott az elektronmikroszkópos képbe, így a nagyítás nem folyamatos. A katalógus szerint az elektronmikroszkópos nagyítás alsó határa $\times 10$, így az optikai és elektronmikroszkópos kép között rés van.

A 2. sz. melléklet 1.3.3. pontja mutatja be a navigációs rendszer működését:

„A felhasználónak a navigációhoz a Stage Navigation ablakot, a fő képernyőn kell megnyitnia, majd ez után térhet vissza az a nagyítás változtatására szolgáló gombhoz a Zeiss SEM Stage Control Board-on a további beállításokhoz. Fentiekre tekintettel Zeiss nem teljesíti a fenti értékelési részszempontot.

A fentiekben hivatkozott felhasználói útmutató releváns részének (13. oldal 1.3.3. pont) felelős fordítása: „A Stage Navigation eszköz a oldalt rögzített panelből elindítható, amely a főnézeti ablak jobb oldalán található. Nyissa le a panelen lévő nyilat, majd kattintson duplán a Stage Navigation elemre. A megnyíló ablakban a kiválasztott mintatartó elektron sugárhoz képest relatív helyzetét mutatja oldal- és felülnézetben. Fontos, hogy a használatban lévő mintatartó a Sample Holder lenyíló menüből legyen kiválasztva, mely az ablak jobb alsó részének közelében található. A megfelelő kiválasztás után a megfelelő minta megtalálása dupla kattintással a megfelelő címkén a legördülő felülnézeti karusszel nézetben történik. Fontos, hogy nagy mozgatás előtt, mely gyakori a használatban, a TV detektor csatorna legyen kiválasztva. Amikor a kívánt mintaterület nagyjából az elektronsugár vonalában van, visszatérhetünk a SEM Stage Control board használatához további beállítások elvégzéséhez.” A fentiek alapján megállapítható, hogy a megajánlott Zeiss Sigma 300 nem teljesíti a nyertes ajánlattevő által a 3.7. értékelési szempont tekintetében megjelölt feltételeket.

A kérelmező kérte, hogy az ajánlatkérő módosítsa a közbeszerzési eljárás 3. részét lezáró döntését és állapítsa meg, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) pontjára tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdése alapján.

15. Az ajánlatkérő 2018. október 8-án felvilágosítást kért a nyertes ajánlattevőtől.

A nyertes ajánlattevő a felvilágosításában közölte, hogy fenntartja korábbi nyilatkozatát a megajánlott készülék felbontóképességével kapcsolatban: képfelbontás értéke nagyvákuumban, 30kV (SE detektor) gyorsítófeszültség mellett 1nm (3.2. értékelési részszempont)

„Mint az a katalógusból is kiderül, a készülék már 15kV gyorsítófeszültség mellett is tudja teljesíteni az 1 nm felbontás értéket, nagyobb gyorsítófeszültség mellett ez az érték még javulni szokott. A STEM utalás azért került a katalógusba, mert ez az üzemmód döntő részben a STEM felhasználók számára jelent információt, hiszen áteső módban van értelme ilyen nagy gyorsítófeszültséget használni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a készülék ne tudná teljesíteni a megajánlott feltételt.

A Zeiss a készüléket egy vezérlő számítógéppel szállítja, amelyben egy teljeskörű vezérlést és mérést lehetővé tevő integrált szoftverrendszer található. Ennek az integrált szoftverrendszernek minden ablaka nyitva van a használat során, a felhasználónak az EDS analízis elvégzéséhez nem kell semmilyen más szoftvert elindítania. A pontelemzés a szekunder vagy visszaszórt elektrondetektoros kép elkészültekor azonnal, időbeli késedelem nélkül, más szoftver megnyitása nélkül elvégezhető. (3.5. részszempont)

A megajánlott Sigma 300 típusú elektronmikroszkóp szoftvere képes optikai képek beolvasására - akár navigációs célból is. A megjelenített optikai kép szokásos, tipikus nagyítása és a megajánlott elektronmikroszkóp induló nagyítása akár azonosan is beállítható. Tehát - a kérelmező szóhasználatával - nincsen „rés” az optikai és az elektronmikroszkópos kép nagyítása között. Ez az extrém nagy - akár több cm-es - látómezejű mód egyébként a megajánlott elektronmikroszkóp típus különlegességének tekinthető. A nagyítás növelésével

az elektronmikroszkópos kép látómezeje megjelenik az optikai képen, orientálva a felhasználót abban a tekintetben, hogy az optikai képen látható minta melyik részletét láthatja az elektronmikroszkópos képen. Ehhez a felhasználónak egy menetben csak a kontrol panelen vagy - egyéni preferencia alapján - a szoftverben elhelyezett nagyítás gombot kell használnia, tehát ezzel egy munkameneten belül, egy gomb használatával megvalósítható a kért funkció. Ezzel az optikai kép nagyításából kiindulva folyamatosan, ugrás nélkül lehet nagyítani az elektronmikroszkópos képig, teljesítve ezzel a kívánt funkciót. Megjegyezni kívánjuk, hogy az ajánlatkérő nem adott meg konkrét nagyításértékeket a 2018.06.18.-án adott kiegészítő tájékoztatóban úgy, ahogy azt a kérelmező indoklásában kifejti. Továbbá a kérelmező által hosszabban részletezett „Stage Navigation” eszköz egy valóban létező, másik segédeszköz, amely valóban a leírás szerint működik, de nincs köze az előzőekben leírt átnézeti optikai képen alapuló (ún. Image navigation - képnavigációs) eszközhöz. Tájékoztatásul csatolom az elektronmikroszkóp egy tipikus optikai képpel azonos nagyítású átnézeti képét, amelyen a teljes mintatartó és környezete is látszik.”

16. Az ajánlatkérő 2018. október 12-én elutasította a fenti indokok alapján a kérelmező előzetes vitarendezési kérelmét.

A jogorvoslati kérelem

17. A kérelmező jogorvoslati eljárást kezdeményezett 2018. október 24. napján benyújtott kérelmével, melyet 2018. október 30. napján hiánypótolta. A jogorvoslati eljárás 2018. október 31. napján indult meg.

A kérelmező a jogorvoslati kérelmében kérte a Döntőbizottságot, hogy a Kbt. 165. § (2) pontjának d) alpontja alapján állapítsa meg a jogsértés megtörténtét a közbeszerzési eljárás 3. részében, semmisítse meg az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő mindhárom kérelmi elem vonatkozásában megsértette a Kbt. 69. § (3) bekezdését, illetőleg a Kbt. 77. § (4) bekezdését azzal, hogy nem megfelelően pontozta a nyertes ajánlattevő kifogásolt három értékelési részszerpontra adott vállalását.

18. Az 1. kérelmi elemben a kérelmező azt kérte vizsgálni, hogy a nyertes ajánlattevő a 3.2. értékelési szempont tekintetében 1 nanométeres értéket ajánlott meg, ezzel a legmagasabb pontszámot kapta, azonban az általa megajánlott termék az alábbi objektív indokok alapján nem alkalmas ezen érték teljesítésére.

A 3.2. értékelési részszerpont a képfelbontás legjobb értéke nagyvákuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsítófeszültség mellett elvárás volt.

A Zeiss Sigma 300 elektronmikroszkóp nem tudja teljesíteni az elvárást. Az ajánlatkérő 2018.06.13-i kiegészítő tájékoztatója alapján a felbontást az ISO/TS 245597:2011 szerinti derivatív módon kérte meghatározni. A megajánlott termék katalógusában a felbontási értékeknél a következő adatok találhatók (30. oldalon található táblázat első 5 sorának felelős fordítása): Zeiss Sigma 300

Elektronforrás Schottky fényforrás

Felbontás* 30 kV-on (STEM) 1.0 nm

Felbontás * 15 kV-on 1.0 nm

Felbontás * 1 kV-on 1.6 nm

Felbontás * 30 kV-on (VP mód) 2.0 nm

*optimális munkatávon, az üzembe helyezés során, a felbontás az átvételi teszten 1kV-on és 15 kV-on igazolt.

A 30 kV-os felbontás STEM módban 1,0 nm, ugyanakkor a katalógusban opcionálisnak feltüntetett (detektorlista 4. sz. melléklet 28. oldal, 10. tétel) a STEM detektort a nyertes ajánlattevő ajánlati ára nem tartalmazza. A felbontás igazolása a megjegyzés alapján csak 1 és 15 kV-on garantált, így 30 kV-os érték az átvételi teszten nem áll rendelkezésre, a felbontási érték nem igazolható. Az ajánlatból ennek megfelelően nem derül ki, hogy a termék ISO kompatibilis derivatív eljárással (vagyis STEM detektor használata nélkül) 30 kV-on teljesíteni tudja az 1,0 nm felbontást.

Az előzetes vitarendezésre adott ajánlatkérői válaszban a „nagyobb gyorsító feszültség mellett ez az érték javulni szokott” megállapítást az ajánlatkérő semmilyen dokumentummal nem támasztotta alá, és ez tényszerűen nem igazolható.

Az ajánlatkérő álláspontja szerint a katalógusban a 30 kV-os gyorsító feszültség 1 nm-es értéke mellett STEM megjelölést csak utalásként kezeli a sajátos, áteső-transzmissziós üzemmódú felhasználási területre.

A nyertes ajánlattevő által megajánlott Sigma 300 készülék háromféle SE képalkotási módot biztosít nagyvákuumban a megfelelő detektorok révén: az SE-In Lens detektorral, SE Everhart Thornley detektorral és STEM detektorral végezhető képalkotás.

Nagyvákuumban a Zeiss Sigma 300 készüléke SE (szekunder elektronok) detektálásra alapesetben In-lens és Everhart-Thornley detektorokat alkalmaz. 15 kV gyorsítófeszültségen a felbontást az SE-In Lens detektor teljesíti. Azonban az SE-In-Lens detektor csak 20 kV-os gyorsítófeszültségig működik. Ennek igazolására csatolta a megajánlott termék tesztelési eredményeit tartalmazó dokumentumot, melynek 6. oldalán szereplő 6. listaelem rögzíti, hogy a készülék „csak nagy vákuumban, 20 kV gyorsító feszültségig alkalmazható (felelős fordítás, eredeti szöveg: only suitable in high vacuum and with acceleration voltages up to 20 kV)

A 20 kV feletti gyorsítófeszültség tartományban csak az Everhart Thornley (ET) detektor működik, amely viszont nem képes az előírt 1 nm-es felbontás teljesítésére. A kétféle detektor közötti különbség, hogy az In-lens detektor a képi információ szempontjából legfontosabb, SE1 típusú elektronokat detektálja és az objektív lencse felett helyezkedik el, míg az Everhart-Thornley (ET) detektor a mintakamrában helyezkedik el és zömében az SE2, SE3 típusú elektronokat detektál, amelyek a minta mélyebb rétegeiből, illetve ütközésből származó elektronok. Ezt a ZEISS SIGMA 2. sz. felhasználói útmutatója is megerősíti (39. oldal, második francia bekezdésének felelős fordítása, eredeti szöveg:

The image generated by the ET-SE detector shows less surface structure due to the contribution from SE3 electrons from the bulk of the specimen (lower layers of the specimen.

Az ET-SE detektor által létrehozott kép kevesebb felszíni szerkezetet mutat a mintatérfogatból (a minta mély rétegeiből) származó SE3 elektronoknak köszönhetően...

A fenti körülmények alacsonyabb felbontást eredményeznek.

A STEM (pásztázó transzmissziós detektálás) az SE detektálástól eltérő képalkotási mód, amely során a STEM detektor (mely a minta alatt helyezkedik el) a mintán áthaladó elektronokat gyűjti, 30 kV gyorsítófeszültségen eredményesen használható és megajánlott felbontás teljesítésére alkalmas. Ezen detektálási módhoz tartozó hardver elemet a nyertes ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a megajánlott Zeiss Sigma 300 nem teljesíti a nyertes ajánlattevő által a 3.2. értékelési szempont tekintetében megjelölt 1 nm értéket.

19. A kérelmező a döntőbizottsági tárgyalást követően a kérelmével összefüggésben azt adta elő az álláspontja megerősítésére, hogy az elektronmikroszkóp gyártók minden esetben a legjobb felbontást adják meg készülékeiknek. Zeiss Sigma katalógusában 30kV gyorsító feszültség mellett 1 nm felbontást jelöl meg STEM módban.

Az elektronmikroszkópok esetében az alábbi képalkotási módok ismertek.

STEM mód

STEM (pásztázó transzmissziós – Scanning Transmission) képalkotó mód az SE- szekunder elektron képalkotó módtól gyökeresen eltér, melyhez dedikált detektor szükséges. STEM detektort a nyertes ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz. Az iratbetekintésen megismert szakmai ajánlata szerint a nyertes ajánlattevő ajánlati ára a következő detektorokat tartalmazza:

- szekunder elektron detektor alacsony vákuum módra
- SE szekunder elektron detektor (Everhart Thornley típusú)
- BSE Visszaszórt elektron detektor
- EDS 30mm² 219 eV energia diszperzív spektrométer.

Szintén ezt támasztja alá továbbá, hogy a Zeiss Sigma katalógus (Zeiss Sigma katalógus detektorlista 28 old.) szerint STEM detektor opcionális tételnek minősül, továbbá ezt a nyertes ajánlattevő jelen jogorvoslati eljárásban tett észrevétele is megerősíti, melynek II. pontjában arról nyilatkozott, hogy „a megajánlott készülék képes teljesíteni az előírt szekunder elektron detektorral is”.

In-Lens mód

Az In-Lens detektor szekunder elektron detektornak minősül, ugyanakkor nem működik 30 kV gyorsító feszültségen (Zeiss Sigma Electron Microscope Instruction Manual 37. oldal 4.2.2.1 pont).

Everhart-Thornley (ET) mód

A fentieknek megfelelően kizárólag ezen képalkotási módban lehet képes arra a készülék a megajánlott felbontási érték teljesítésére, amely ugyanakkor az alábbi indokok alapján nem lehetséges.

Az ET működési elve

Az elektronsugár a minta felületéhez érve, behatol a mintába és kölcsönhatásba lép a minta atomjaival. A kérelmező által csatolt képen látható SE2 jelölésű szekunder elektronok kölcsönhatásba lépnek a visszaszórt elektronokkal a mintában és a primer (az elektron ágyúból beeső) elektronsugár hatására szélesebb területről érkeznek, így alacsonyabb felbontás érhető el velük. Hasonlítható ez a hagyományos kamera pixel felbontásához: nagyobb pixel méret kevésbé jó felbontást eredményez; nagy SE2 emissziós terület=nagy pixel, kis SE1 emissziós terület=kis pixel.

A gerjesztett területről másodlagos (SE) és visszaszórt (BSE) elektronok lépnek ki.

Az SE1-el jelölt elektronok kis szögben a „csepp” nyakának felszíni részéről, kis emissziós területről származnak (az ábrán „SE escape depth” kis mélységből). Minőségileg ezek a képalkotás szempontjából legkedvezőbb szekunder elektronok.

BSE (visszaszórt) elektronok pedig a gerjesztési térfogat mélyebb részeiről.

SE2 elektronokat BSE elektronok gerjesztik kiszélesítve a „csepp” nyakát

SE3 elektronok BSE elektronok szóródásából jönnek létre, a mikroszkóp alkatrészeiből származnak, zajt okoznak a képen.

Az ET detektor gyűjtőfeszültség segítségével vonzza magához az elektronokat, így nem csak az ideális SE1-et hanem SE2, SE3 jeleket is, amely alacsonyabb felbontást eredményez (Forrás <https://www2.nau.edu/micro-analysis/wordpress/index.php/signals/>)

Szekunder electron komponensek

<https://www2.nau.edu/microanalysis/wordpress/index.php/signals/>

In-lens és Everhart Thornley, Zeiss Sigma manual 46. oldal 4.19
http://www.iitk.ac.in/meesa/SEM/SEM_manual.pdf
 STEM Detektor, Zeiss Sigma manual 64. oldal 4.36
http://www.iitk.ac.in/meesa/SEM/SEM_manual.pdf
 In-lens és Everhart Thornley felbontás különbség, Zeiss Sigma manual 39. oldal 4.2.2.2
http://www.iitk.ac.in/meesa/SEM/SEM_manual.pdf)

STEM üzemmóddal való összehasonlítás

A STEM üzemmódban a transzmissziós elektronmikroszkópiában használthoz hasonlatos, speciálisan vékony mintát alkalmaznak. A minta szükségszerűen a lehető legvékonyabb (az elektronok áthaladása érdekében a gerjesztési térfogat mélységénél vékonyabb), így a mintán az elektronok áthaladnak az elektronok a minta atomjaiban különböző mértékben elnyelődnek vagy ütközés nélkül áthaladnak, így alakul ki a sötét-világos kontraszt különbség (transzmissziós működési elv).

Az esetleges szóródásokat, melyek a nem kívánatos elektronjelekből erednek egy apertúra (blende) segítségével „levágják”, így ezek nem torzítják a képet.

A ZEISS Sigma 300 STEM detektora gyűrűs félvezető típusú, nem alkalmaz gyűjtőfeszültséget így a szóródott elektronokat nem vonzza magához. Éppen ezért a STEM detektor által gyűjtött jel nem torzított SE2 és SE3 elektronokkal. A STEM detektor így jobb felbontás értéket ad, mint SEM üzemmódban az ET SE detektor. A nagyon vékony mintát speciális transzmissziós mintahordozóra (grid) kell felhelyezni. Ezt a szekunder, in-lens és STEM detektorok elhelyezkedése szemlélteti (ET SE detector Zeiss Sigma Electron Microscope Instruction Manual 46. oldal 4.19 http://www.iitk.ac.in/meesa/SEM/SEM_manual.pdf, STEM detector Zeiss Sigma Electron Microscope Instruction Manual 64. oldal Scanning Transmission Electron Microscopy (STEM) detector, http://www.iitk.ac.in/meesa/SEM/SEM_manual.pdf)

Amennyiben tehát a STEM üzemmódban 1 nm a legmagasabb felbontása a szóban forgó terméknek, akkor tényszerűen igazolható, hogy az Everhart-Thornley detektor nem lehet képes ezen érték elérésére.

In-Lens móddal való összehasonlítás

A megajánlott termék esetében az Everhart Thornley detektor SE1 és SE2 szekunder jeleket detektál, amíg az In-lens detektor sokkal kisebb területről (kisebb pixel-jobb felbontás) kis szögben emittált szekunder elektronokat detektál, így in-lens detektor azonos gyorsító feszültség mellett jobb felbontással rendelkezik.

A fenti levezetést alátámasztja Zeiss Sigma Electron Microscope Instruction Manual dokumentuma 39. oldal 4.2.2.2 pont (www.iitk.ac.in/meesa/SEM/SEM_manual.pdf), mely az in-lens detektor előnyeit mutatja be összehasonlítva az Everhart Thornley detektorral:

A lényegi információt a második bekezdés második mondata tartalmazza: az in-lens detektor „ideális eszközt jelent a minta felszínének letérképezésére. Még nagy gyorsító feszültségen is, azok a képek, melyek az in-lens detektorból származó információkat használják, több felszíni információt tartalmaznak, mint ami az ET (Everherdt Thornley) detektor használatával elérhető lenne.”

Amennyiben tehát a STEM üzemmódban 1 nm a legmagasabb felbontása a terméknek, akkor tényszerűen igazolható, hogy az Everhart-Thornley detektor nem lehet képes ezen érték elérésére.

20. A nyertes ajánlattevő hivatkozott vállalása megfelelőségének az alátámasztására a Wikipédia vonatkozó szócikkére. Eszerint „a De Broglie-képlet[6][27] alapján minél magasabb a gyorsítófeszültség, annál alacsonyabb hullámhossz érhető el. (Louis de Broglie[28]). Az alacsonyabb hullámhossz az Abbe-egyenlet[29] alapján nagyobb felbontóképességet tesz lehetővé.”

A fenti szövegrészletet csak a hullámhossz tekintetében vizsgálja a felbontást, más tényezőket, mint az elektronok mintában való ütközése, vagy a színi/gömbi torzítás nem vesz figyelembe, amelyek jelentős mértékben befolyásolják a felbontást. Az idézett szövegrészlet az alábbi, a nyertes ajánlattevő által hivatkozott szócikket pontosító bejegyzéssel együtt értelmezendő, melyet dr. Pozsgai Imre, a magyar elektronmikroszkópia úttörője, számos egyetemi tankönyv szerzője tesz:

„Megkülönböztetünk pásztázó elektronmikroszkópot (PEM vagy angolul SEM), pásztázó transzmissziós elektron mikroszkópot (STEM), transzmissziós elektronmikroszkópot (TEM) illetve a TEM/STEM kombinációt. A szövegben említett Abbe-képlet csak a fénymikroszkópiában és a transzmissziós elektronmikroszkópiában releváns, a pásztázó elektronmikroszkópiában nem. Klasszikus értelemben vett optikai leképezés, ahol az optikai törvényei alapján meghatározzuk a sugármenetet és a leképezést, a pásztázó elektronmikroszkópban nincs. A PEM elektronoptikájának egyetlen feladata, hogy vékony elektronnyalábot állítson elő és a mintából pontonként gyűjtött információt (elektronokat vagy röntgensugárzást vagy fényt stb.) erősítés után egy képernyőn ugyanolyan sorrendben képpé alakítsa”.

A cikkben előforduló mondat „a De Broglie-képlet[6][27] alapján minél magasabb a gyorsítófeszültség, annál alacsonyabb hullámhossz érhető el. (Louis de Broglie[28]). Az alacsonyabb hullámhossz az Abbe-egyenlet[29] alapján nagyobb felbontóképességet tesz lehetővé” igaz, de csak a fénymikroszkópra és a transzmissziós mikroszkópra igaz a PEM-re nem. (A fenti idézet szerzője Dr. Pozsgai Imre https://hu.wikipedia.org/wiki/Vita%3AP%C3%A1szt%C3%A1z%C3%B3_elektronmikroszk%C3%B3p).

A nyertes ajánlattevő hivatkozott egy, az ELTE oktatói által készített jegyzetre is, mellyel kapcsolatban az álláspontja a kérelmezőnek, hogy az ebben foglalt megállapítások nem vonatkoztathatóak jelen esetre, ezek ismételtelen csak az adott dokumentumból önkényesen kiragadott részletek, a nyertes ajánlattevő álláspontját alátámasztandó. A dokumentum 11. ábra alapján ugyanis egyértelművé válik, hogy a publikáció során a kutatók csak az szekunder, 1-10 nm mélységből visszaszórt röntgen és auger elektronokat vizsgálták, így a magyarázat csak ezekre vonatkozik.

A nyertes ajánlattevői gyártói igazolás nem tartalmazza, milyen felbontási módszerrel érik el az 1 nm-es felbontást 30 kV-os gyorsító feszültségen. Az ajánlatkérő az ISO kompatibilis derivatív eljárást határozta meg a felbontás meghatározásának módszereként. Ez a meghatározási módszer kép jel/zaj arányát is számításba veszi a felbontás meghatározásánál a szélkontraszt számítás mellett, így a felbontási értékkel szemben szigorúbb követelményeket támaszt. A Zeiss által használt felbontás meghatározási módszer a 25/75%-os szélkontraszt módszer (<https://www.reliableplant.com/Read/14535/carl-zeiss-sets-world-record-in-microscopy-resolution>: a felbontás számszaki értéke a 25/75%-os szélkontraszt módszerrel kedvezőbb eredményt ad, mint derivált módszerrel).

A nyertes ajánlattevő azon állítása igaz, hogy nagyobb gyorsítófeszültség nagyobb a felbontás, amennyiben ugyanarról a detektorról van szó. A katalógus azonban az 1,0 nm/30 kV felbontásban STEM módot jelöl meg és nem SE módot.

A legjobb felbontás akkor érhető el szekunder elektron detektorral, ha nincs STEM, vagy in-lens detektor a konfigurációban. Ezt a következtetést a fenti hivatkozások nem támasztják alá.

A nyertes ajánlattevő azt is nyilatkozta, hogy „a modern trendeknek megfelelően felületi vizsgálatánál – tehát alap üzemmódban – a kisebb gyorsító feszültség melletti felbontás a fontos, ezért adja meg ezt a gyártó 15 kV gyorsítófeszültségnél nagyobb gyorsító feszültségeknél jobb lenne a felbontás, de más hatások miatt pl. egyes anyagok feltöltődése a gyakorlatban ez nem alkalmazott.”

Az elektronmikroszkópiában alkalmazott gyorsítófeszültség tartományai az alábbiak:

- 1 kV-ig: ultra alacsony gyorsító feszültség
- 1-5 kV-ig: alacsony gyorsító feszültség
- 5-10 kV átmeneti tartomány
- 10 kV-on felül nagy gyorsító feszültség.

Ennek megfelelően a 15 kV-os gyorsító feszültség ugyanúgy nagy feszültség tartományba esik, mint a 30 kV. Az alacsony, kis energiás feszültségen mért felbontási értéket meg is találjuk Zeiss Sigma katalógusában 1kV -nál.

Másrészről a „15 kV gyorsítófeszültségnél nagyobb gyorsító feszültségeknél jobb lenne a felbontás, de más hatások miatt pl. egyes anyagok feltöltődése a gyakorlatban ez nem alkalmazott” megjegyzés hibás, az átvételi tesztet nem feltöltődő, speciális tesztmintán végzik, ez nem lehet akadálya a 30 kV gyorsítófeszültségen elvégzendő tesztnek. Egyébként 30 kV-os gyorsító feszültséget általánosan használnak elemanalízis esetén.

21. A kérelmező álláspontja szerint az ajánlatkérő észrevétele nem tartalmaz új információt. Az ajánlatkérő által hivatkozott ábra (<https://www.globalsino.com/EM/page4603.html>) képaláírása: „Figure 4603c. Schematic illustration of spatial resolutions of SEMs with various lenses.” melynek felelős fordítása: a 4603c ábra a különböző lencsékkel rendelkező SEM-ek térbeli felbontása sematikus illusztrációja. A dokumentum ennek megfelelően nem detektorokat, hanem lencserendszereket hasonlít össze, melyből Sigma 300 csak az In-lens lencsét tartalmazza.

Az ET mód tekintetében egyetértett a megállapítással, hogy Zeiss ET detektor meg sem közelíti 20 kV-on az In-lens detektor felbontását. A további magyarázatot, mely a felbontást csak a hullámhosszhoz, mint egyetlen tényezőhöz kapcsolja, a nyertes ajánlattevő észrevételei esetében már megcáfolta.

Az ajánlatkérő által hivatkozott Youtube videót tovább nézve (<https://www.youtube.com/watch?v=m0hNA4bO9kY> How to increase SEM resolution) 3:05 percnél a moderátor megmagyarázza, miért nem evidencia a felbontás növekedése a gyorsítófeszültség növelésével: nagyobb gyorsító feszültség esetén az elektronok mélyebbre hatolnak a mintában, nem csak a felszínről származó szekunder elektronok, hanem mély rétegekből származók is keletkeznek, rontva a képi információ minőségét.

22. A 2. kérelmi elemben a 3.5. értékelési szempont tekintetében megajánlott ajánlati elemet kifogásolta a kérelmező. Ebben azonnali pontelemzés a szekunder és visszaszórt élő képen második szoftver megnyitása nélkül szerinti funkció akkor teljesíthető, ha az FESEM vezérlő operációs rendszere ugyanabban az időben, egyszerre kezeli a pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) élő kép és elemanalízis funkciókat. A Zeiss Sigma VP FE SEM

használati útmutatója 9. oldalán található információk szerint (1.2.1. Software startup) a Sigma 300 a SmartSEM operációs rendszert használja, mely csak a SEM funkciókat vezérli, míg az elemalízist nem. A Zeiss nem energia diszperzív spektrométer gyártó, a szekunder és visszaszórt élő képen a pontelemzés elvégzésére egy külső EDS gyártó második szoftverét (pl. APEX szoftver) kell megnyitnia. A kérelmező esetében a pásztázást és az EDS analízist egy scan generátor látja el egy szoftver irányításával, míg Zeiss esetében két scan generátorra és két szoftverre van szükség.

„1.2.1 Software Startup

The microscope is controlled entirely by the SmartSEM software suite developed by Zeiss.”

„1.2.1 Szoftver indítása

A mikroszkópot teljes mértékben a Zeiss által kifejlesztett SmartSEM szoftver vezérli.”

Az előzetes vitarendezési eljárásban adott ajánlatkérői válasszal összefüggésben azt emelte ki, hogy „nyitva van a vezérlő szoftver összes szoftver ablaka” nem jelenti azt, hogy a berendezés képes a pontelemzést közvetlenül az élő képen elvégezni, melynek képablakában a szekunder és visszaszórt kép egyaránt megjeleníthető. Ez akkor lehetséges, ha a képalkotást és a pontanalízist egyetlen szoftver végzi. A Zeiss ugyanakkor nem rendelkezik saját gyártmányú EDS (energia diszperzív spektrométer, pontelemzést végző) berendezéssel, az általa megajánlott termék más gyártó EDS szoftverét használja, így ez egy külön szoftver, amelyet a megajánlott készüléknek használnia kell.

A megajánlott Zeiss Sigma 300 nem teljesíti a nyertes ajánlattevő által a 3.5. értékelési szempont tekintetében megjelölt feltételeket.

23. A kérelme ezen elemének az alátámasztásra előadta, hogy a piaci ismereteit arra alapozza, hogy a Zeiss nem EDS/EDX energia diszperzív spektrométer gyártó, ezért nincs olyan saját szoftvere, mely a két – képalkotó és analízis funkciót egyben ellátná. Ennek igazolására csatolta a Magyar Mikroszkópos Társaság nyilatkozatát arról, hogy az egyesület vezetésének milyen mikroszkóp és EDS gyártókról van tudomása, amely hitelt érdemlően támasztja alá a piaci információit, továbbá ugyanezen állítást igazolja a francia Elektronmikroszkóp Társaság elnökének levele (üzleti titok), valamint az elektronmikroszkóp gyártók és forgalmazók honlapja is (<http://www.gn-meba.org/constructeurs/distri.htm>).

Azt is hangsúlyozta, hogy az azonnali pontelemzés az élő képen második szoftver megnyitása nélkül ajánlatkérői elvárás azt jelenti, hogy nem a kép elkészültekor (azaz az után), hanem pásztázás közben (élő képen) a szekunder, vagy visszaszórt képen egy pontot kijelölve a pont elemalízis összetételét/spektrumát kapjuk. A funkció úgy ellenőrizhető, ha elmozdítjuk a mintát, a rendszer az új pont képanalízis és spektrum adatait veszi fel, nem a már felvett adatokhoz adja az analízis eredményeit (amennyiben az előző pont adatait a rendszer nem törli a pont változásakor, az új pont analízise hamis lesz). A funkció úgy érhető el, ha a képalkotást és az analízist egyetlen szoftver végzi, mivel így egyetlen pásztázással elérhető mind a kép, mind az analízis információ. Az azonos szoftver nem egyenlő azzal, ha egy számítógépet használunk, melynek minden ablaka nyitva van, vagy szoftverrendszeren belül külön szoftver/modul kezeli a két funkciót.

Ennek igazolására hivatkozott a <https://www.azom.com/materials-video-details.aspx?VidID=681> címen elérhető, a megajánlott termék működését bemutató videóra. A videón a Zeiss készülék Sigma Brucker EDS analitikai rendszerrel van felszerelve, mely esetén három monitort látható: az első a mintatartó optikai képe navigáció számára, 2. a fő elektronmikroszkópos képablak, 3. Brucker EDS szoftver ablak. A videón 3:35 percnél az operator frissíti az elektronmikroszkópos képet (monitor2), de a Brucker EDS analitikai

ablakában (monitor3) kijelzett analízis nem frissül. Ez azt jelenti, hogy külön képalkotó és EDS elemanalízis szoftver működik.

Ezt támasztja alá továbbá a Zeiss weboldalán található információ is (<https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/scanning-electron-microscopes/sigma.html>), amely szerint „a felhasználás javítására az EDS és a ZEISS SEM vezérlése csak egy PC-t használ. Ugyanakkor a párhuzamos vezérlés a mikroszkóp és az EDS vezérléssel ellátott felhasználói interfészek használatával lehetséges”. A párhuzamos vezérlés a SEM és EDS vezérléséhez több felhasználói interfészt használ az egynél több szoftver vezérlése miatt.

Az ajánlatkérő a vitarendezési kérelemre adott válaszában, továbbá jelen jogorvoslati eljárás keretében tett észrevételében akként nyilatkozott, hogy a „pontelemzés a szekunder vagy visszaszórt elektrondetektoros kép elkészültekor azonnal, időbeli késedelem nélkül, más szoftver megnyitása nélkül legyen elvégezhető.”

Tekintettel tehát arra, hogy kép készül az analízis során, semmiképpen sem lehet arról, hogy az elemzés élő képen történik.

A nyertes ajánlattevő észrevételeire reagálva előadta, hogy az általa hivatkozottan frissen megjelent Smart szoftverrendszer továbbra is két szoftvert/modult tartalmaz, mely külön kezeli a képi és analitikai feladatokat. A SmartSEM és SmartEDX modulok hasonlíthatók a Microsoft Office csomaghoz, ahol a Word és Excel modulok/szoftverek más feladatokat látnak el.

Azt is kiemelte, hogy a nyertes ajánlattevő élő képre vonatkozó definíciója téves. Az elektronmikroszkóp képalkotásának folyamatában az adott időpontban történő pásztázás, és ugyanabban az időpontban történő képalkotás folyamata tekinthető az élő kép funkciónak, ebben az időintervallumban kell a pontelemzést elvégezni, melyet az általa megajánlott termék képes teljesíteni. Amikor a pásztázás befejeződik, és a kép mentésre kerül a „freeze” (fagyasztás – mentés) funkcióval, az „éppen elkészült kép” mentett kép, már nem tekinthető a pásztázás folyamatában lévő élő képnek.

A képalkotást és az EDS analízis egyetlen szoftvernek szükséges kezelnie az előírás teljesítésére, azzal a kiegészítéssel, hogy mindezt az élő képen kell teljesíteni. Abban az esetben, ha SEM és EDS nem ugyan azon gyártó terméke, a hardverek és hozzájuk tartozó szoftverek más fejlesztési koncepciót követnek. A kommunikációt közöttük interfészek (adapterek, kapcsolódási felületek) valósítják meg. Ez azonban továbbra sem teljesíti az egyetlen szoftver használatának kritériumát.

A Sigma 300 katalógusa is dedikált (egyedileg hozzárendelt) interfészeket említ SEM és EDS vezérlésének megvalósítására. (<https://www.zeiss.com/microscopy/us/products/scanning-electron-microscopes/sigma.html> Accessories, Integrated EDS Solution).

A nyertes ajánlattevő nem jelölte meg a megajánlott EDS eszköz és szoftver gyártóját, valamint annak pontos típusát.

Az ajánlatkérő által hivatkozott SmartPI szoftver nem a SEM képalkotó szoftver (az a SmartSEM szoftver), hanem egy speciális szoftver opció, a „Smart Particle Investigator” szemcseelemző szoftvercsomag leírása. A hivatkozott referencia (<https://www.machinerylubrication.com/Read/2265/zeiss-scanning-electron-microscope>) nem 2018. augusztus 17-én, hanem sokkal régebben, 2009. augusztus 17-én jelent meg a forráshelyen: A szoftver interfészekeken keresztül kapcsolja össze az egyes mikroszkópkezelési funkciókat. A szoftver leírásában olvasható („Fully integrated solution – Teljesen integrált megoldás” részben): „SmartPI keeps all data together, assuring both SEM and EDS data integrity and efficient data recall.”, melynek felelős fordítása: „A SmartPI az összes adatot

együtt tartja, biztosítva mind a SEM, mind az EDS adatok integritását (az adatok sértetlenségét) és a hatékony adat visszahívást.” Tehát a SmartPI a szoftvercsomag egyes szoftverei által mentett adatokat hív vissza és nyit meg a csomag másik szoftverében, de a funkciókat külön szoftver egységek látják el, melyet alátámaszt a nyertes ajánlattevő korábbi válasza, ahol különálló szoftvereket SmartSEM és SmartEDX szoftvereket említett.

A Zeiss ezen speciális szoftverhez kapcsolódóan a saját honlapján az alábbiakat szerepelteti: <https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/microscope-software/smartpi.html>

„Even when the EDS system is sourced from an EDS supplier, the entire SmartPI system is supported by the global ZEISS service and applications team – keeping all customer care under one roof”, melynek felelős fordítása: „Még ha az EDS más gyártótól származik is, az egész SmartPI rendszer a globális Zeiss szerviztől és applikációs csoporttól támogatott, a felhasználóról való gondoskodást egy kézben tartva.” Ez alapján egyértelműen igazolt, hogy az EDS szoftver nem Zeiss terméke, képalkotást konkrétan elvégző szoftver lehet nem azonos az EDS spektrumot felvevő szoftverrel. Kettejük közötti kapcsolatot csak átkapcsolással tudja Zeiss megvalósítani.

24. A kérelmező 3. elemében a jogorvoslati kérelmének a 3.7. értékelési szempont tekintetében megajánlott ajánlati elemet kérte vizsgálni. A folyamatos nagyítás optikai képről (pl. navigációs kép) az elektronmikroszkópos képig elvárás, miszerint ezt a funkciót egy gomb használatával kéri elérni, a nyertes ajánlattevő eszköze nem teljesíti.

Ez a funkció akkor teljesíthető, ha az optikai, vagy navigációs kép és az elektronmikroszkópos kép egymásba beágyazott. Az optikai, vagy navigációs kép nagyítás nélkül (vagy kevesebb, mint 1x nagyítással) kijelzett. A megajánlott termék a katalógus alapján nem tud nagyítani az optikai képről az elektronmikroszkópos képig (x600.000) egy gomb használatával. A katalógus 8. oldalán látható kép mutatja be a kamera képét, melyet a lokáció meghatározására használnak. Ez a kép nem beágyazott az elektronmikroszkópos képbe, így a nagyítás nem folyamatos. A katalógus szerint az elektronmikroszkópos nagyítás alsó határa x10, így az optikai és elektronmikroszkópos kép között rés van.

A navigációs rendszert bemutató dokumentum szerint a felhasználónak a navigációhoz a Stage Navigation ablakot a fő képernyőn kell megnyitnia, majd ez után térhet vissza az a nagyítás változtatására szolgáló gombhoz a Zeiss SEM Stage Control Board-on a további beállításokhoz. Fentiekre tekintettel Zeiss nem teljesíti a fenti értékelési részszerzőpontot. A fentiekben hivatkozott felhasználói útmutató releváns részének (13. oldal 1.3.3. pont) felelős fordítása:

„The Stage Navigation tool can be launched from the docking side-panel seen on the right of the main viewing window. Click the arrow on the panel to expand it and then double-click the item labelled Stage Navigation. The window that opens shows both a side and top-down view of the currently selected carousel relative to the electron beam. It is important to make sure that the carousel that is currently in use is the one selected in the Sample Holder dropdown near the bottom right of the window. Once properly selected, finding the right sample is as easy as double-clicking on the appropriate label in the top-down carousel view. Again, it is important to have the TV detector channel selected before moving the stage by large amounts, as is common while using the Stage Navigation tool. Once the sample of interest is roughly in line of the electron beam, it is customary to revert back to using the SEM Stage Control board for further adjustments.”

„A Stage Navigation eszköz a dokkoló oldalsó panelből elindítható, amely a főnézeti ablak jobb oldalán található. Kattintson a panelen lévő nyílra a kibontáshoz, majd kattintson duplán a Stage Navigation elemre. A megnyíló ablakban a kiválasztott mintatartó az elektron sugárhoz képest relatív helyzetét mutatja oldal- és felülnézetben. Fontos, hogy a használatban lévő mintatartó a Sample Holder lenyíló menüből legyen kiválasztva, mely az ablak jobb alsó részének közelében található. A megfelelő kiválasztás után a megfelelő minta megtalálása dupla kattintással a megfelelő címkén a legördülő felülnézeti karusszelnézetben történik. Fontos, hogy nagy mozgatás előtt, mely gyakori a használatban, a TV detektor csatorna legyen kiválasztva.

Amikor a kívánt mintaterület nagyjából az elektronsugár vonalában van, visszatérhetünk a SEM Stage Control board használatához, további beállítások elvégzéséhez.”

A vitarendezési kérelemre adott ajánlatkérői választ érintve a kérelmező előadta, hogy a válaszában nem a vitatott műszaki tulajdonságra reagált. Az ajánlatkérő szerint „a megjelentett optikai kép szokásos, tipikus nagyítása és a megajánlott elektronmikroszkóp induló nagyítása akár azonosan is beállítható.” Ehhez azonban az optikai képen kalibrációként referenciapontok felvétele szükséges, hogy megfeleltessék az elektronmikroszkópos képnek, mely a folyamatos nagyítást kizárja, mivel a nagyításon kívül más műveletre is sor kerül. A nyertes ajánlattevő által csatolt igazoló kép navigációra nem alkalmas, mivel a központi területen kívüli részeken a kép erősen torzított.

25. A folyamatos, azaz az optikai képről megszakítás nélküli munkamenetben az elektronmikroszkópos képig funkció jelentése, hogy az optikai képen elkezdett nagyítás a nagyítás növelésével a kép átvált az elektronmikroszkópos képre, minden egyéb beállítás változtatása és munkamenet megszakítása nélkül – bezoomolunk a nagy nagyításba. A funkciót a kiegészítő tájékoztatás szerint egy gomb segítségével kell elvégezni. Ennek szemléltetésére hivatkozott a kérelmező által megajánlott termék ezen funkcióját bemutató videóra (üzleti titok).

A nyertes ajánlattevő több módszerre hivatkozott válaszában.

Zeiss Image navigation

Külső forrásból származó kép tölthető fel. A feltöltés után az asztalon kell regisztrálni, létrehozva a kalibrációt a kép és a mikroszkóp asztal között. Csak ezután lehet a kalibrált képen navigálni (SmartSEM vezérlő szoftver 304. oldal 6.2.18 Image Navigation (<https://chepec.se/assets/related/150320-Zeiss-SmartSEM-software-manual.pdf>)).

A külső, állvánnyal felszerelt kamerával felvett a mintáról készült optikai kép korrelál elektronmikroszkópos képekkel. A folyamatos nagyítás eléréséhez a nagyítás elvégzésén túl egy keresztezett poláris tartozék (Crossed Polar accessory) szükséges, illetve az optikai kép méretét szoftver segítségével kalibrálni kell az elektronmikroszkópos képhez (a kalibráció szükségességét a nyertes ajánlattevő is említette). Kalibráció nélkül a nagyítás nem használható, mely nem jelentheti az egy munkamenetben, azaz „egy gombbal” történő alkalmazást, vagyis nem alkalmas a funkció teljesítésére.

Ezt a rendszert a Zeiss egy kisebb elektronmikroszkópjához, a Zeiss Evo rendszerhez ajánlja. (www.hwkessel.com.pe/web/121728f/EVO-Brochure.pdf 33. old. Ease of use).

Zeiss Fisheye mód

A nyertes ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban benyújtott felvilágosításában hivatkozott az „Image navigation device” eszközre, egy erősen torzított átnézeti (elektronmikroszkópos) képet csatolt igazolásul. Ezen kép a készülék „Fisheye” módban történő működését szemlélteti (SmartSEM vezérlő szoftver 72-73. oldal, melyet Sigma 300 használ) felhasználói

kézikönyvében

(<https://chepec.se/assets/related/150320-Zeiss-SmartSEM-software-manual.pdf>).

A SmartSEM vezérlő szoftver Fisheye mód leírása a következőket rögzíti: „mivel a kép a fisheye lencse effektus miatt erősen torzított, mérés és a nagyítás pontos meghatározása nem lehetséges.” Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő felvilágosításában szereplő azon állítás, miszerint „a megjelenített optikai kép szokásos-, tipikus nagyítása és a megajánlott elektronmikroszkóp induló nagyítása akár azonosan is beállítható” nem igazolható, mivel az induló kép nagyítása sem meghatározható. Az értékelési szempont optikai képről és elektronmikroszkópos képig nagyítást határoz meg, az opcionális Fisheye mód pedig elektronmikroszkópos képet jelenít meg.

Stage Navigation

A <https://www.azom.com/materials-video-details.aspx?VidID=681> címen elérhető videó 3:52 percénél az elektronmikroszkópos kép látómezejének referencia keresztje jól láthatóan megjelenik az optikai képen, orientálva a felhasználót arról, hogy az optikai kép melyik részlete látható az elektronmikroszkópos képen. Az 1. monitoron látható, a mintáról készült optikai kép, melyen piros kereszt mutatja a látómezőt. A 2. monitoron a nagyított elektronmikroszkópos kép kijelzett, nincs folyamatosság a két kép között.

A kért funkció optikai képről (pl. navigációs kép) elektronmikroszkópos képre váltó folyamatos, egy gombbal kivitelezhető nagyítást ír elő. Ez azt jelenti, egy menetben, más változtatás/beállítás nélkül kell a funkciót megvalósítani. Nincs folyamatosság a két kép között. A kért funkció optikai képről (pl. navigációs kép) elektronmikroszkópos képre váltó folyamatos, egy gombbal kivitelezhető nagyítást ír elő. Ez azt jelenti, egy menetben, más változtatás/beállítás nélkül kell a funkciót megvalósítani.

A kérelmező az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő által e körben előadott nyilatkozataira reagálva azt adta elő, hogy az Image Navigation funkciója működését a <https://www.youtube.com/watch?v=1Wh3Jb9BF3c> címen elérhető videó szemlélteti (1:03 másodperctől). A videón a képalkotási folyamat részei az optikai képfelvétel külső kamerával, a mintatípus meghatározás, az optikai kép a látómező megjelenítésével, és az elektronmikroszkópos nagyítás látszanak.

Az optikai kép és az elektronmikroszkópos kép külön egység a folyamatban, az optikai képről kiindulva nem jutunk el egy menetben az elektronmikroszkópos képig, át kell váltani egy másik képre, ahol az elektronmikroszkópos kép megjelenített.

Az egyedi képenként felvett elektronmikroszkópos felvételek összeállítása a <https://www.youtube.com/watch?v=ura-ofOu7Y8> címen elérhető videón látható, melyen a szoftver az előzetesen elmentett különböző nagyítású elektronmikroszkópos képeket fűzi össze, melyet kalibrálnak az optikai képpel. Ez nem jelent folyamatos átmenetet, lehetetlen végtelen kis lépésekben, minden nagyításon minden egyes képet felvenni. A nagyításban való léptetést az operátor a képre történő kattintással változtatja, ezzel előhívja a következő mentett képet. Amennyiben az ajánlatkérő célja az értékelési szemponttal a navigáció, ebben az esetben fenti megoldás erre nem alkalmas, mivel az elektronmikroszkópos képeket már előzetesen el kellett készíteni, hogy a nagyítást a fenti módon összefűzzék, már előzetesen navigálni kellett a mintán.

A nyertes ajánlattevő térképes hasonlatával élve, az előírt funkció értelmében a felhasználó nem a térképet kívánja használni, hanem Google Earth-höz hasonló navigációt kér, ahol rá tud keresni és egyben nagyítani az adott müncheni utca címére anélkül, hogy ehhez külön térképeket kellene használnia.

A Fisheye funkciót vizsgálva a kérelmező továbbra is azt állította, hogy az optikai kép nem azonos az elektronmikroszkópos képpel. Az optikai képek készítéséhez fotonokat, az elektronmikroszkópos képhez elektronokat használnak. A Zeiss hivatalos információi alapján hivatkozott adatok szerint a Fisheye mód nagyítása nem meghatározható, azt más nagyítással összehangolni ezért nem lehet. A mód 100 V-os gyorsítófeszültségen igen kis energián készül, nagyon nagy munkatávon (15-50mm). Ezek a beállítások nem a Zeiss képalkotási beállításai. Ebben az esetben sem teljesül, hogy az optikai képről nagyít a rendszer az elektronmikroszkópos képig.

26. A kérelmező tanút állított elő a tárgyalásra és szükség esetén kérte a jogorvoslati kérelemben foglaltak körében vitatottak szakmai alátámasztására meghallgatni.

Az ajánlatkérő észrevétele

27. Az ajánlatkérő kérte az álláspontja szerint alaptalan jogorvoslati kérelem elutasítását.

28. A közbeszerzési eljárásban a 3.2. értékelési részszempont (1. kérelmi elem) vonatkozásában a 2018.06.13-i kiegészítő tájékoztatásában a felbontást az ISO/TS 245597:2011 szerinti derivatív módon kérte meghatározni. A nyertes ajánlattevő megajánlott termék (Zeiss Sigma 300) katalógusában a felbontási értékeknél a következő adatok találhatók:

	Zeiss Sigma 300
Elektronforrás	Schottky fényforrás
Felbontás* 30 kV-on (STEM)	1.0 nm
Felbontás * 15 kV-on	1.0 nm
Felbontás * 1 kV-on	1.6 nm
Felbontás * 30 kV-on (VP mód)	2.0 nm

*optimális munkatávon, az üzembe helyezés során, a felbontás az átvételi teszten 1kV-on és 15 kV-on igazolt.

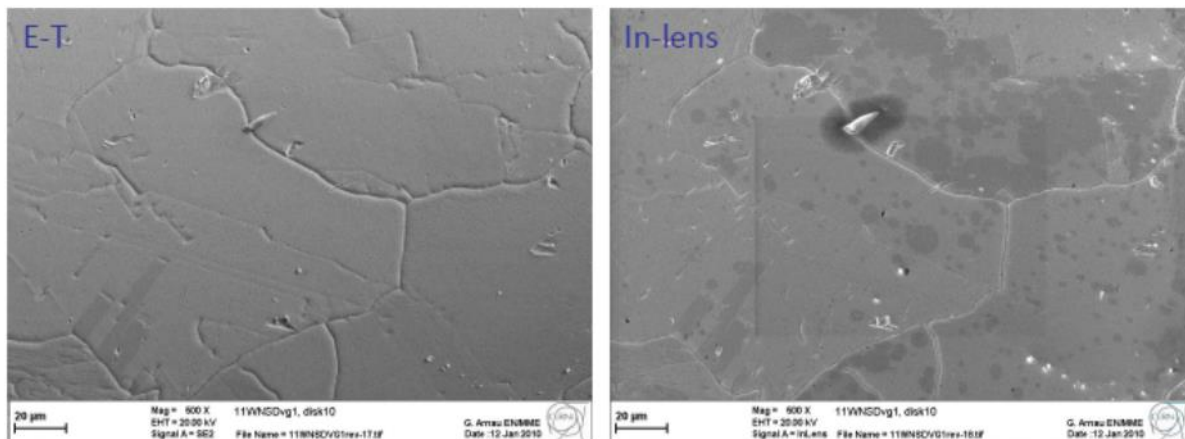
Az értékelés során elfogadta és nem vitatta, hogy a SEM elméleti fizikai törvényszerűsége szerint magasabb kV érték jobb felbontást biztosít. A STEM utalás álláspontja szerint azért szerepel a katalógusban, mert ez az üzemmód döntő részben a STEM felhasználók számára jelent információt, mivel ilyen módban van értelme ilyen nagy gyorsító feszültséget használni. Ez a kifejezés azonban nem jelenti azt, hogy a készülék ne tudná teljesíteni a megajánlott feltételt.

A kérelmező által az elektronmikroszkópok detektorai tekintetében előadta, hogy a nyertes ajánlatban sehol sem szerepelt STEM detektor. A hivatkozott katalógusadat csak arra utal, hogy, hogy 30kV-os gyorsítófeszültséget jellemzően STEM módban használják.

Az In-Lens detektorok általában jobb felbontást biztosítanak, mint a "hagyományos" pl. ET detektorok (<http://www.globalsino.com/EM/page4603.html>).

A linkben található Figure 4603c képen is látszik, a függőleges tengelyen a felbontás mértéke (nm) a vízszintes pedig a gyorsító feszültség értéke (kV) van. Az ábrán jól látszik az In-Lens (sárga görbe) technológia nagyobb kV értékek mellett bőven az 1 nm felbontás alá is képes menni.

Az Everhart-Thornley (ET) módban a jó felbontáshoz kell a magasabb kV érték, 20 kV-on meg sem közelíti az In-Lens felbontását.



29. A Carl Zeiss kamra szekunder elektron detektort használ. A fizika szabályai szerint, ha egy elektronmikroszkóp 15kV gyorsítófeszültség mellett képes 1nm felbontás teljesítésére, az 30kV gyorsítófeszültség mellett is képes erre. A De Broglie-képlet alapján minél magasabb a gyorsítófeszültség, annál alacsonyabb hullámhossz érhető el. Az alacsonyabb hullámhossz az Abbe-egyenlet alapján nagyobb felbontóképességet tesz lehetővé. A felbontás hullámhosszfüggő, azaz minél kisebb a hullámhossz, annál nagyobb a felbontás. Az elektronmikroszkópban alacsonyabb gyorsító feszültség nagyobb hullámhosszú elektronsugarakat gerjeszt, nagyobb gyorsító feszültség pedig rövidebb hullámhosszú elektronsugarakat.

Gyorsító feszültség (kV)	Hullámhossz (nm)
50	0,0055
100	0,0039
200	0,0025
1000	0,0012

(forrás:

<https://myscope.training/legacy/sem/background/concepts/whatisresolution.php#detail>)

youtube - How To Increase SEM Resolution - Northwestern University

(Hogyan növelhető a SEM felbontása, válasz a videóban 2 perc 40 másodpercnél:
<https://youtu.be/m0hNA4bO9kY>).

A 15kV/1nm adat elérhető a Carl Zeiss prospektusában (https://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/821E6142AE9C5305C1257E1B0031B3A1/%24FILE/EN_40_011_096_Sigma_Family_2-3.pdf).

<http://metal.elte.hu/oktatas/alkfizlab/meresleirasok/SEM3.pdf>

„A 11. ábrán is látszik, hogy a SEM-ben általában képképzésre felhasznált termékek közül a szekunder elektronok 1-10 nm mélységből származnak (a nyaláb energiájától függően). Ezért a legnagyobb felbontás a szekunder elektron képpel érhető el.” Ezek biztosan más forrásokban is megvannak, és ebből levezethető az egyetem elfogadó magatartásának indoklása.

30. A 2. kérelmi elem (3.5. értékelési szempont) tekintetében kiemelte, hogy a nyertes ajánlattevő a készüléket egy vezérlő számítógéppel szállítja, amelyben egy teljeskörű vezérlést és mérést lehetővé tevő integrált szoftverrendszer található. A szoftverrendszernek minden ablaka nyitva van a használat során, ezért a felhasználónak nem kell az EDS analízis elvégzéséhez semmilyen más szoftvert elindítania. A pontelemzés a szekunder vagy visszaszórt elektrondetektoros kép elkészültekor azonnal, késedelem nélkül, és más szoftver megnyitása nélkül elvégezhető. A nyertes ajánlattevő által megajánlott termék teljesíti az értékelési szempont szerinti paramétert.

31. A kérelmező állításával kapcsolatosan előadta, hogy az alábbi honlapon olvashatóan a Zeiss már 2018. augusztus 17-én megjelentette a SmartPI szoftvert, mely kezeli az EDX rendszert is második szoftver megnyitása nélkül is. (<https://www.machinerylubrication.com/Read/2265/zeiss-scanning-electron-microscope>) A „SmartPI integrálja a teljes SEM vezérlést, képfeldolgozást, EDX analízist egyetlen egy applikációban”, ezek alapján fogadtuk el a Zeiss válaszát.

A nyertes ajánlattevő az értékelési szempontnak való megfelelését továbbá azzal indokolta, hogy az élőkép és a valós idő csak úgy értelmezhető, ha az elkészült képekre vonatkozik. A SEM ugyanis soronkénti pásztázással állítja elő a képeket, tehát ha egy kép teteje - mondjuk a felső harmada - már kész van, és éppen a középső harmadánál jár a soronkénti pásztázás, akkor e felső harmad már nem „élő” és nem beszélhetünk „valós időről” sem. A szoftveres integráció után (amit 2018. október 15-én dobtak piacra) az interneten is fellelhető a párhuzamos működésre és a dedikált, egyszerre működő felhasználói felületre vonatkozó utalások. (<https://www.zeiss.com/microscopy/us/products/scanning-electron-microscopes/sigma.html>)

32. A 3. kérelmi elem vonatkozásában (3.7. értékelési szempont) az ajánlatkérő kiemelte, hogy álláspontja szerint a nyertes ajánlattevő által megajánlott készülék szoftvere képes optikai képek beolvasására. A megjelenített optikai kép szokásos, tipikus nagyítása és a megajánlott elektronmikroszkóp induló nagyítása akár azonosan is beállítható. A nagyítás növelésével az elektronmikroszkópos kép látómezeje megjelenik az optikai képen, orientálva a felhasználót, hogy az optikai képen látható minta melyik részét láthatja az elektronmikroszkópos képen. Ehhez a felhasználónak csak szoftverben elhelyezett nagyítási gombot kell használnia, így egy munkameneten belül egy gomb használatával megvalósul az előírt funkció.

33. Az ajánlatkérő fontosnak tartotta kiemelni, hogy az elektronmikroszkópos és az optikai kép nem határozható meg egzakt módon, azaz hogy hány-szoros nagyításig minősül egy kép optikainak. Ez nagymértékben függ a minta méretétől, az alkalmazott munkatávolságtól (vagyis a minta és az elektronoptikai oszlop véglencséjének távolságától) valamint attól, hogy egy adott minta makro és mikrostruktúrájának jellemző méretei esetén mit nevezünk optikai és elektronmikroszkópos képnek. Az optikai kép alatt alapvetően egy kis felbontású képet kell érteni. Ez elsősorban navigációs célt szolgál (eligazodás az adott mintán belül).

Egy ilyen kép több módon is előállítható, pl. hagyományos lencsével. Azonban a navigációs cél akkor is meg tud valósulni, ha ez a kis felbontású (optikai) kép előállítható az elektronmikroszkópos módszerrel.

A Carl Zeiss SEM egy Gemini típusú széles nagyítástartományon használható elektronoptikával rendelkezik, amely elektronoptika széles nagyítástartománnyal rendelkezik.

Ez a legkisebb nagyításon képes olyan széles látómezős képalkotásra, amelyen látható a minta-asztal teljes felülete és annak környezete. Majd ebből a képből történő nagyítás ezután egyetlen gomb forgatásával elérhető.

Pontosan az elektronmikroszkóp nagyítástartománya teszi lehetővé, hogy az elektronmikroszkópos módszerrel létrehozható legyen egy kis nagyítású (egyben nagy látómezőjű) kép ahhoz, hogy a tájékozódás megvalósítható legyen.

34. Az ajánlatkérő tanút állított elő a tárgyalásra a vitatott döntésének a megalapozottsága körében kérte meghallgatni.

Az egyéb érdekelt Carl Zeiss Technika Kft. észrevétele

35. A nyertes ajánlattevő kérte a jogorvoslati kérelem elutasítását.

36. Eljárásjogi kifogással élve kifejtette, hogy a tárgyaláson a kérelmező érvénytelenségről áttért az értékelési pontozás kifogásolására, így egy új kérelmi elemmel egészült ki a jogorvoslati kérelem. A jogorvoslati gyakorlat, illetőleg a Kbt. vonatkozó szabályai szerint is mind ténybelileg, mind jogilag új tények és jogi kifogásolás alá eső Kbt. rendelkezések kerültek megjelölésre. Ezért elsődlegesen kérte ennek vizsgálatát és szükség esetén az igazgatási szolgáltatási díj kiegészítésére a kérelmezőt és ennek fényében kerüljön megtartásra a következő tárgyalás. Ezt a nyilatkozatát fenntartotta a másik két kérelmi elem tekintetében is, amennyiben a kérelmező ebben a körben is másképp nyilatkozik, mint ami a jogorvoslati kérelemben rögzítésre került.

37. Érdemben előadta, hogy az ajánlata megfelel a kiírási feltételeknek, az ajánlatkérő eljárást lezáró döntése megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek. A közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozatát fenntartva az 1. kérelmi elemben nevesített 3.2 értékelési szempontnak való megfelelés körében a megajánlott készülékek katalógusadataira reagálva közölte, hogy azok a leggyakoribb felhasználásokra standard körülmények között vonatkoznak. A 30 kV-os gyorsítófeszültség STEM detektoros felhasználás mellett értelmezhető, az alkalmazások döntő többségében így használják, ezért a katalógus is erre a felhasználásra utal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az általa megajánlott készülék szekunder elektron detektorral ne lenne képes teljesíteni a megadott felbontás értéket. Álláspontja szerint a jogorvoslati kérelemben hivatkozott állítások legfeljebb részben igazak, az azokból levont következtetés viszont nem állja meg a helyét. Az általa megajánlott készülék képes teljesíteni az előírást szekunder elektron detektorral is, és ennek megfelelően nyilatkozott az ajánlatában és kész az adott műszaki követelmény teljesítését a beüzemelés során méréssel is igazolni.

38. A fizikában elfogadott, hogy ha egy elektronmikroszkóp 15kV gyorsítófeszültség mellett képes 1nm felbontás teljesítésére, az 30kV gyorsítófeszültség mellett is képes erre. Ennek alátámasztására idézte a Wikipédia szócikkének kiemelt részét: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1szt%C3%A1z%C3%B3_elektronmikroszk%C3%B3p#A_páasztázó_elektronmikroszkóp_felbontása „A De Broglie-képlet alapján minél magasabb a gyorsítófeszültség, annál alacsonyabb hullámhossz érhető el. (Louis de Broglie). Az alacsonyabb hullámhossz az Abbe-egyenlet alapján nagyobb felbontóképességet tesz lehetővé.”

39. További alátámasztásként utalt a hivatkozott szócikk 11. ábrája feletti fejezet végén (9. oldal) olvasható (<http://metal.elte.hu/oktatas/alkfizlab/meresleirasok/SEM3.pdf>): „A 11. ábrán is látszik, hogy a SEM-ben (Scanning Electron Microscope) általában képalkotásra felhasznált

termékek közül a szekunder elektronok 1-10 nm mélységből származnak (a nyaláb energiájától függően). Ezért a legnagyobb felbontás a szekunder elektron képpel érhető el.”

40. Ha egy pásztázó elektronmikroszkóp kisebb gyorsítófeszültségnél tudja teljesíteni az előírt felbontást, akkor egy nagyobb gyorsítófeszültségnél még jobb felbontást képes elérni. A rendelkezésre álló detektorok közül a szekunder elektron detektorral érhető el a legjobb felbontás. Az ET detektor működési elve ismert a nyertes ajánlattevő előtt, az SE1, SE2, SE3 elektronok különböző tulajdonságai, ezzel együtt a Sigma ET detektora képes a megfelelő felbontás előállítására. A hivatkozott szakirodalmi adatok nem a Zeiss belső anyagai, hanem teljesen függetlennek tekinthető, magyar nyelven publikált internetes szakirodalmi anyagok, ráadásul az ELTE jegyzet egy JEOL elektronmikroszkóp gyakorlati mérési útmutatójával folytatódik

41. Az ajánlatában nem szerepel STEM detektor. Abban 2 féle szekunder elektron detektor (SE detektor) is szerepel, amelyet kifejezetten megerősített az ajánlatban. (Műszaki leírás, Elvárt műszaki paraméterek excel táblázat, 29. sor, Everhart-Thornley SE detektor – Igen). A megajánlott típus alapértelmezett kiépítésben tartalmazza mindkettőt: Úgynevezett „lencsébe épített” (In-lens) szekunder elektrondetektor (Letölthető pdf prospektus, 28. oldal, első sora:

[https://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/821E6142AE9C5305C1257E1B0031B3A1/\\$FILE/EN_40_011_096_Sigma_Family_2-3.pdf](https://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/821E6142AE9C5305C1257E1B0031B3A1/$FILE/EN_40_011_096_Sigma_Family_2-3.pdf) „In-lens SE detektor, felelős fordításban „lencsébe épített szekunder elektron detektor”). Ez valóban nem működtethető 20kV gyorsítófeszültség fölött, de nem is állította, hogy ezzel kívánja teljesíteni a felbontás előírást. A hagyományos szekunder elektron detektor a kamrában helyezkedik el és képes a fent idézett szakmai szempontok alapján a felbontás teljesítésére.

A kérelmező által hivatkozott katalógusadat (1nm 30kV (STEM) mindössze arra utal, hogy 30kV-os gyorsítófeszültséget jellemzően áteső, tehát vékony mintametszeteken áthatoló módban használják, elsősorban a nagyobb energiájú elektronok nagyobb áthatoló képessége miatt. A modern trendeknek megfelelően felületi vizsgálatánál – tehát az alap üzemmódban - a kisebb gyorsítófeszültség melletti jó felbontás a fontos, ezért adja meg ezt a gyártó 15kV gyorsítófeszültségnél nagyobb gyorsítófeszültségeknél jobb lenne a felbontás, de más hatások miatt, pl. egyes anyagok feltöltődése a gyakorlatban ez nem alkalmazott.

A felbontás előírás teljesítésének igazolására csatolta a gyár központjának nyilatkozatát: „Felbontást igazoló dokumentum a Sigma 300-as téremissziós pásztázó elektronmikroszkóp család vonatkozásában: Térbeli felbontás: A Sigma 300-as termék specifikációs dokumentumban megadott adatokon túlmenően igazoljuk, hogy széria termékünk teljesíti a következő értéket: SE kamra detektor 30kV: 1nm”

A gyártói nyilatkozat, ami ugyanolyan bizonyító erővel bír, mint a kérelmező által hivatkozott, eszközre vonatkozó gyártói katalógus egyértelműen igazolja, hogy a megajánlott eszköz teljesíti az előírt értéket.

42. A 2. kérelmi elembe hivatkozott 3.5 értékelési szempontnak való megfelelést tekintve az általa megajánlott mikroszkóp integrált módon tartalmazza a Smart szoftverrendszert a SmartSEM és SmartEDX modulokkal. Érthető, ha a kérelmező számára nem ismert a 2018.10.15.-én megjelent SmartEDX modul. Ezzel a szoftverrendszerrel a kért pontelemzés a megjelenéssel egyidőben elvégezhető akár szekunder akár visszaszórt SEM képen.

Utalt továbbá az ajánlatkérő 2. és 3. sz. kiegészítő tájékoztatásában az ezzel kapcsolatos előírásokra.

Eszerint a megajánlott eszköznek képesnek kell lennie azonnali pontelemzésre a szekunder és visszaszórt élő képen második szoftver megnyitása nélkül, ugyanazon szoftver kezelje a

képalkotást és az EDS analízist, a vizsgált terület valós idejű elemanalízise a SEI/BEI megfigyelés közben (kép, spektrum, analízis eredménye és az elemek egyszerre megjelenítettek), az EDS spektrumnak egy időben kell megjelennie az élő képen kijelzett képpel.

A készüléket egy vezérlő számítógéppel szállítja, amelyben egy teljes körű vezérlést és mérést lehetővé tevő integrált szoftverrendszer található. Ennek az integrált szoftverrendszernek minden ablaka nyitva van a használat során, a felhasználónak az EDS analízis elvégzéséhez nem kell semmilyen más szoftvert elindítania (hasonlóan egy operációs rendszerhez). A pontelemzés a szekunder vagy visszaszórt elektrondetektoros kép elkészültekor azonnal, időbeli késedelem nélkül, más szoftver megnyitása nélkül elvégezhető. A nyertes ajánlattevő e körben üzleti titkot képező dokumentációt csatolt.

Kiemelte, hogy a közbeszerzés tárgyát képező pásztázó elektronmikroszkóp soronként tapogatja le a minta felületének egy téglalap alakú darabját. Ahogy a vezérlő elektronika először a legfelső sorban az X tengely mentén lépteti a pásztázó elektronnyalábot, majd egyet lépve az Y tengely mentén lefelé letapogatja a következő sort. Ez így megy soronként egyre lejjebb, míg a kép legalsó sorának végére ér. Ez egy kis időt vesz igénybe, ahhoz hogy megfelelő legyen a jel/zaj arány ugyanazokat a sorokat többször is le kell tapogatni egymás után (soronkénti átlagolás). Ezen kívül pontonkénti és képenkénti átlagolást is lehet végezni. Részletdús, jó jel/zaj arányú képek elkészítése több percig is eltarthat, de ez erősen függ a minta anyagától. Annak természetesen nincs akadálya, hogy az elektronmikroszkóp folyamatosan pásztázzon, azaz a kép aljára érve rögtön újrakezdje a pásztázást a kép tetején annak alátámasztására, hogy a szakirodalom is időben bontott működési módnak tekinti a fent leírt pásztázó módot és így határozottan megkülönbözteti a SEM rendszereket az azonos időben képet alkotó TEM (transzmissziós elektronmikroszkóp) rendszerektől, hivatkozott a következő linkre:

[https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1szt%C3%A1z%C3%B3_elektronmikroszk%C3%B3p#K%C3%A9palkot%C3%A1s_id%C3%B5ben_bontott_\(p%C3%A1szt%C3%A1z%C3%B3\)_rendszerekkel](https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1szt%C3%A1z%C3%B3_elektronmikroszk%C3%B3p#K%C3%A9palkot%C3%A1s_id%C3%B5ben_bontott_(p%C3%A1szt%C3%A1z%C3%B3)_rendszerekkel)

„Képalkotás időben bontott (pásztázó) rendszerekkel

Képek előállíthatók a vizsgált objektum tulajdonságainak időben eltérő, részletenkénti megfigyelése és detektálása, majd ezek síkvetületének megfelelő rendszer szerinti rekonstrukciójával.[6] A tárgy egyes részleteinek leképzése ilyenkor időben szétválasztva, egymás után történik.”

A közbeszerzés tárgyát képező SEM mikroszkópok tekintetében valós élőképről és valós idejű képalkotásról csak olyan értelemben beszélhetünk, ami a frissen elkészült képre vagy éppen befejezett képre vonatkozik, mert amikor a folyamatos pásztázás során a kép alja kirajzolódik, akkor a tetején lévő sorok már régen elkészültek és egy múltbeli állapotot mutatnak. Az élőképet ezek alapján „éppen elkészült kép” értelemben használjuk.

Az ajánlatkérő előírása az azonnali pontelemzés körében a szekunder és visszaszórt élő képen második szoftver megnyitása nélkül. Az ajánlatában erre igen választ adott, mivel éppen elkészült képen a pontelemzés azonnal elvégezhető, akár szekunder, akár visszaszórt detektorral készültek. Mindehhez nem kell második szoftvert megnyitni, hiszen ezek azonos időben elérhetőek és dedikált felhasználói felülettel rendelkeznek. Ennek alátámasztására idézte a megajánlott Sigma 300-as típus weboldalát: „Take advantage if Sigma Element, an integrated EDS solution with high usability and low-kV sensitivity. Improve usability by using only one PC to control both your EDS and ZEISS SEM. At the same time, parallel control is possible by having dedicated user interface for microscope and EDS control.

(<https://www.zeiss.com/microscopy/us/products/scanning-electron-microscopes/sigma.html>)

Felelős fordításban: „Tartozékok a Zeiss Sigma 300-hoz Beépített EDS megoldás Nagyfelbontású képalkotás és alacsony energiájú analízis egyidőben.

Használja ki az integrált EDS megoldást nyújtó Sigma Element előnyeit, mely kimagaslóan alkalmazható és alacsony gyorsítófeszültségek mellett is érzékeny. Növeli használhatóságát, hogy egyetlen számítógép elegendő az EDS rendszer és a ZEISS SEM vezérlésére. Ugyanakkor a dedikált felhasználói felületeknek köszönhetően párhuzamosan használható a mikroszkóp és az EDS vezérlése.”

Az ugyanazon szoftver kezelje a képalkotást és az EDS analízist elvárását is képes az általa megajánlott eszköz teljesíteni. A fenti idézet alátámasztja, hogy közös felhasználói felületen párhuzamosan kezeli a rendszer a képalkotást és az EDS analízist.

A vizsgált terület valós idejű elemanalízise a SEI/BEI megfigyelés közben (kép, spektrum, analízis eredménye és az elemek egyszerre megjelenítettek), a valós időt itt a kép elkészültének idejére kell érteni, mivel a kép szekvenciálisan, sorról-sorra alakul ki. SEI/BEI (szekunder és/vagy visszaszórt elektronmikroszkópos) megfigyelés közben a kép, ill. az EDS rendszerből származó spektrum, analízis eredménye és elemek egyszerre jelennek meg a képernyőn.

Az EDS spektrumnak egy időben kell megjelennie az élő képen a kijelzett képpel elvárásnak megfelelően az EDS spektrum egyszerre, egy időben látható a képernyőn az élő képen kijelzett képpel – azzal a kiegészítéssel, hogy az élő képen megint csak a teljes mértékben az utolsó sorig lépáosztott képet kell érteni.

43. A 3.7 értékelési szempontnak való megfelelés körében (3. kérelmi elem) megajánlott mikroszkóp képes optikai képről is és nagy látómezejű SEM képről is navigálni. Mindkét megoldás alkalmas a funkció megvalósítására. Az értékelési szempontban meghatározott folyamatos nagyítás ugyanazon gomb követelmény megfogalmazása nem zárja ki sem előzetes kalibrációs pontok felvételét, sem a peremtorzítások minimális mértékére nem ad előírást. Így a megajánlott berendezés műszaki megoldása kielégíti a megadott feltételt, és a minimális peremtorzítás nem befolyásolja a navigációs funkciót.

A nyertes ajánlattevő álláspontja szerint ebben az értékelési részszempontban egy funkció megvalósításáról van szó. Ez a funkció azt jelenti, hogy egyetlen folyamatos művelettel lehessen széles nagyítástartományban képet alkotni. Ez a széles nagyítástartomány az értékelési résszempont megfogalmazása szerint a közelebből nem definiált optikai és elektronmikroszkópos nagyítások közötti tartományt jelenti. A funkció előírásának egyik célját a navigáció.

Ennek a funkciónak a teljesítése nagymértékben függ a minta méretétől, az alkalmazott munkatávolságtól (vagyis a minta és az elektronoptikai oszlop véglencséjének távolságától), valamint attól, hogy egy adott minta makro- és mikrostruktúrájának jellemző méretei esetén mit nevezünk optikai és elektronmikroszkópos képnek. Az optikai kép egy kis nagyítású képet jelent, ezt elő lehet állítani hagyományos fényképezőgéppel, fénymikroszkóppal, kamerával, de ha az elektronmikroszkóp nagyítástartománya lehetővé teszi, akkor a célnak ugyanúgy megfelelhet egy elektronmikroszkópos kép. A funkció szempontjából mindegy, hogy milyen úton állítják elő a képeket, a lényeg az, hogy kell egy kis nagyítású (egyben nagy látómezejű) kép ahhoz, hogy tájékozódni lehessen a mintán. Hasonlattal élve, ha Németországon belül kell megtalálni Műnchent, akkor először nem a München térképet kell elővenni, hanem a Németország térképet.

Példával is érzékeltetve a minta lehet egy 3x3 mm-es közet darab, amely teljes egészében megjeleníthető az elektronmikroszkóppal egy kisebb nagyítással és bármely részletébe

belenagyíthatunk 1.000.000x-os nagyítással, ahol csak néhány ezred vagy milliomod mm-es részletek látszódnak. A fent említett részletek nincsenek definiálva az ajánlatkérő értékelési szempontjában.

Azt is hangsúlyozta, hogy több módszerrel megfelel az ajánlatkérő előírásának.

Image navigation (kép alapján történő navigáció): A kérelmező beadványban hivatkozott forrás egy 2012 novemberében kiadott SmartSEM felhasználói kézikönyv. Azóta változott a Zeiss navigációs kamerája. Az új kamera lehetővé teszi, hogy külön regisztráció, kalibráció nélkül is felhasználható legyen navigációs célra. Az értékelési szempontban nem volt előírva az, hogy nem lehet előzetes beállítási műveleteket elvégezni csak az, hogy a nagyítás elvégzése legyen folyamatos, egy gombbal elvégezhető. Ezzel együtt a navigációs kamera új változata már a beállító műveleteket sem igényli.

A képnavigációs mód működésének illusztrálására becsatolt egy képet, amelyen egyszerre látható a navigációs kép és az elektronmikroszkópos részletkép. A jobb oldali navigációs képen piros téglalap jelzi az elektronmikroszkópos kép helyét.

A megajánlott készülék működésének bemutatására külön mellékletben csatolt egy linket, amelyen egy videó felvétel található, melynek tartalma üzleti titok.

A felvételen a jobb oldali navigációs kép és az elektronmikroszkópos kép is nagyítható külön, egyszerűen az egér görgőjével szabadon navigálhat a mintán. Ezzel az üzemmóddal is megvalósítható az ajánlatkérő előírása.

Ezen felül úgy is történhet a navigáció a képen, hogy kihasználásra kerül a Sigma 300 elektronoptikájának széles látómező tartománya. A legkisebb nagyításon a Sigma 300 képes egy teljes mintáról áttekintő képet alkotni, majd ennek a képnek a kis részleteit a nagyítás gomb forgatásával leképezni. Az előzetes vitarendezés során becsatolt képen egy ilyen áttekintő kép látható úgynevezett Fisheye (halszem) módban. Valójában a megfeleléshez a nagyítástartomány Fisheye kiterjesztése a kis nagyítások felé nem is szükséges, mert a Sigma 300 már az alap nagyítás tartományában is elegendően széles határokkal rendelkezi

Ezen tények alapján az általa megajánlott eszköz teljesíti, valamennyi fent említett értékelési feltételt. Az ajánlatkérő felvilágosítás kérésére megfelelően bemutatta, hogy az egyes értékelési szempontokat a megajánlott eszköz milyen módon teljesíti, ennek megfelelően az ajánlatkérő jogszerűen értékelte az ajánlatát, és a közbeszerzési eljárást lezáró döntése megfelel a Kbt. rendelkezéseinek.

44. Hivatkozott arra, hogy korábban 2016. előtt az EDS detektort gyártó cégek teljesen külön kiegészítő eszközként árulták detektoraikat. Ez külön detektort, külön számítógépet, külön szoftveres környezetet jelentett. Az EDS elemanalízis elvégzéséhez a pásztázó elektronmikroszkóp képalkotását le kellett állítani, a kép kimerevedett, az EDS rendszer szoftvere átvette a vezérlést és elvégezte az elemanalízist, megjelenítette a spektrumot és az elemeket. A Zeiss 2016 során kezdett egy integrációs folyamatba. Először csak azonos számítógépen futott a két szoftver, de külön megnevezés és brand név alatt (Zeiss SmartSEM a pásztázó elektronmikroszkóp vezérlésére és EDAX Apex (gyártó) az EDS rendszer vezérlésére). Az integráció újabb lépése volt, hogy a két szoftverrendszert a Zeiss teljesen egybeintegrált, a piacon kizárólagosan ZEISS brand név alatt árulja és a szoftvereket modulokként integrálta SmartSEM és SmartEDX megnevezéssel. A katalógusban ez 2018. október 15-én jelent meg, de ez az információ előtte már májusban ismert volt.

45. Bizonyos értelemben minden szoftver több, egymással együttműködő szoftver részletből áll. Akkor beszélhetünk integrált szoftverrendszerről, ha a különböző részek együttes működése olyan új lehetőségeket teremt, amelyek a részek külön-külön használatával

nem állítható elő. Az új megoldás fő jellemzője, hogy integrált, magyarul beépített, egybeépített. A kérelmező által használt Word-Excel hasonlatnál maradván inkább olyan a SmartSEM – SmartEDX együttműködése, mint az Excel beépülő moduljai vagy egy operációs rendszer egyes elemei.

A másik ismérve a különálló szoftvereknek, hogy a felhasználónak külön el kell indítania valamilyen alkalmazást és gondoskodnia kell az adatok átviteléről: az egyik alkalmazás eredményét lementeni, a másikkal pedig ezt megnyitni. A beépülő modulok esetében a felhasználó számára nem észlelhető, hogy a háttérben több modul dolgozik és nem kell megnyitnia semmit, így egy szofverrendszerrel beszélünk. A <https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/scanning-electron-microscopes/sigma.html> az Accessories részben van egy rövid dokumentáció. Eszerint az EDAX – ennek a termékének a vonatkozásában - egy olyan egyszerű beszállítóvá vált, mint a többi több száz meg nem nevezett és üzleti titokként kezelt beszállító. Más megfogalmazásban az EDAX ebben a szerepében úgynevezett OEM gyártó, azaz ezt a terméket nem árulja önálló termékként, kizárólag a Zeiss részére és kizárólag abból a célból, hogy új elektronmikroszkópokba integrálják.

Már a korábbi, az ajánlatkérő ismert alacsonyabb integráltsági fokú műszaki megoldás is teljesítette az ajánlatkérő előírásait, de a később megjelent, a piacon 2018. október 15-én bejelentett továbbfejlesztett műszaki megoldás csak még nagyobb mértékben alkalmas erre. Természetesen – mint a gyártó 100%-os tulajdonában álló kereskedelmi képviselőnek – már a piaci bejelentés előtt voltak ismeretei a továbbfejlesztett változatról.

46. A nyertes ajánlattevő a Döntőbizottság által megtartott második tárgyalást követően nyújtott be észrevételt, amit a Döntőbizottság a Kbt. 160. § (4) bekezdése alapján nem vett figyelembe a döntése meghozatalakor.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

47. A Döntőbizottság a felhívás feladásának időpontjában 2018. május 18. napján hatályos Kbt. rendelkezések alapján bírálta el a jogorvoslati kérelmet.

48. A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálata előtt az ajánlatkérő azon hivatkozását vizsgálta meg, hogy a kérelmező a jogorvoslati kérelmét új kérelmi elemekkel egészítette-e ki a jogorvoslati eljárásban akkor, amikor az értékelés során hozott ajánlatkérő döntés körében a nyertes ajánlattevő érvénytelenségének a vizsgálata helyett az ajánlatkérői pontkiosztást, annak helyességét vitatta és ezért ki kellett-e az igazgatási szolgáltatási díjat egészítenie a kérelmezőnek.

49. A Kbt. 2. § (7) bekezdése szerint e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi.

50. A Kbt. 3. § 16. pontja szerint kérelmi elem a Döntőbizottsághoz benyújtott jogorvoslati kérelemnek az az elkülöníthető része, amely tartalmazza a jogsértőnek vélt kérelmezetti eljárási cselekményt, magatartást, döntést vagy mulasztást a megsértett jogszabályi rendelkezés(ek) megjelölésével, valamint a Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt és annak indokait, azzal, hogy a kérelmező ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének érvénytelenségét megállapító ajánlatkérői döntés vitatása egy kérelmi elemet képez, kivéve, ha valamely érvénytelenségi okhoz egyéb jogkövetkezmény is fűződik.

51. A Kbt. 148. § (1) bekezdése alapján a Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul.

(2) Kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő, a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén bármelyik részvételre jelentkező vagy az egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, illetve ezek módosításának, valamint a 113. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás jogsértő volta miatt kérelmet nyújthat be a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdekképviselői szervezet is. (E bekezdésben foglaltak a továbbiakban együtt: kérelmező)

52. A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért - ideértve a koncessziós beszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárást is - igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A (3) bekezdése szerint az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Kbt. 3. § 16. pontja szerint megjelölt kérelmi elemek számához igazodóan a következő:

- a) 1-3 közötti számú kérelmi elem esetében a díj mértéke megegyezik a (2) bekezdés szerint meghatározott összeggel;
- b) 4-6 közötti számú kérelmi elem esetében a (2) bekezdés szerint meghatározott összeg 125%-a.

53. A Döntőbizottság az egyéb érdekelt hivatkozása alapján megvizsgálta a jogorvoslati kérelem tartalmát. Ez alapján azt állapította meg, hogy a kérelmező az egyéb érdekeltnek, mint nyertes ajánlattevőnek a 3.2, 3.5. és a 3.7 értékelési részszerzőponthoz adott vállalatát vitatta az 1-3. kérelmi elemében és azt állította, hogy az abban foglalt vállalatok nem teljesítik az ajánlatkérő előírásában meghatározott műszaki tartalmat. Ezzel összefüggésben a kérelmező az egyéb érdekelt ajánlatának érvénytelenségét állította a jogorvoslati kérelmében, mint jogkövetkezményt és ezt kérte a jogorvoslati eljárásban megállapítani is, a megjelölt jogszabályi rendelkezések is ennek megfelelően a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) pontjára tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja voltak.

54. A jogorvoslati eljárásban a kérelmező az értékelési szempontokhoz kapcsolódóan a kifogásolt ajánlatkérői döntést változatlan tartalommal és indokolással fenntartotta, csupán az értékelésre tekintettel nem az egyéb érdekelt ajánlatának az érvénytelenségét állította és kérte vizsgálni, hanem a pontkiosztás körében kérte annak vizsgálatát. A kérelmező a megjelölt jogszabályi rendelkezéseket is ennek megfelelően Kbt. 69. § (3) bekezdésére illetőleg a Kbt. 77. § (4) bekezdésére pontosította.

55. A Döntőbizottság ezt a pontosítást nem tekintette új kérelmi elemnek, mivel a kérelmező a Kbt. 3. § 16. pontjában meghatározott kérelmi elem fogalmát alapul véve mindvégig az értékelés körében végzett ajánlatkérői eljárást és döntést kifogásolta. Az ajánlatkérői eljárás vonatkozásában az annak alapjául szolgáló tényállást, annak indokait nem módosította, a jogkövetkezményre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket pontosította. A jogorvoslati kérelem mindvégig az ajánlatkérői értékelését kérte vizsgálni, a Döntőbizottság tájékoztatása alapján a kérelmező a jogkövetkezmények tekintetében az érvénytelenség helyett a megfelelő pontkiosztás elmaradását kérte megállapítani, mely alapján azonban a kérelmező a kérelmet nem egészítette ki új elemmel. A kérelmező továbbra is kérte a jogsértés megállapítását és az ajánlatkérőnek a 3. részben hozott döntése megsemmisítését és vele szemben bírság kiszabását, mely nem tekinthető új elemnek az előterjesztett kérelemhez

képest, illetve ezen utóbbi elemek a Döntőbizottság döntésére irányuló indítványok voltak, a kérelmező ezeket pontosította a jogorvoslati eljárásban.

Erre tekintettel a Döntőbizottság nem hívta fel a kérelmezőt további igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére.

56. A Döntőbizottság a kérelmező és az ajánlatkérő bizonyítási indítványát mellőzte, hogy az általa nevesített és a tárgyalásra előállított tanúkat hallgassa meg. A Döntőbizottság a tárgyaláson lehetővé tette a feleknek, így a kérelmezőnek is, hogy a Kbt. 160. § (2) és (4) bekezdése alapján a tárgyalást követően részletes észrevételeket tegyenek a tárgyalást követően megtett nyilatkozatokra és a tárgyaláson elhangzottakra.

57. A Kbt. 144. §-a alapján alkalmazandó általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 62. §-a alapján [*A tényállás tisztázása*]

(1) Ha a döntéshozatalhoz nem elegendők a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le.

(2) A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték.

(3) A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.

(4) A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.

58. Az Ákr. vonatkozó szabálya alapján a Döntőbizottság nem hallgatta meg a kérelmező és az ajánlatkérő által előállított tanúkat, mivel a szabadon megválasztható bizonyítási eszközök közül az Ákr. 63. §-ában és a Kbt. 160. §-ában nevesített ajánlattevő nyilatkozatot választotta.

59. Ezt követően azt vizsgálta meg a Döntőbizottság, hogy az ajánlatkérő a kifogásolt három kérelmi elem tekintetében az előírásának megfelelően végezte-e el a nyertes ajánlattevő 3.2., 3.5. és 3.7. értékelési részszempontja tekintetében (1-3. kérelmi elem) az értékelést.

60. A releváns rendelkezések a következők:

Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 2014/24/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: 2014/24/EU Irányelv)

(89) bekezdése szerint „az odaítélési szempontok fogalma ezen irányelv központi elemét képezi. Ezért a rá vonatkozó rendelkezéseket a lehető legegyszerűbb és legésszerűbb módon kell megfogalmazni. Ez a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” kifejezés fő koncepcióként való használatával érhető el, hiszen végső soron minden nyertes ajánlatot aszerint kell kiválasztani, hogy az egyes ajánlatkérő szervek a felkínáltak közül mit tekintenek a gazdasági szempontból, összességében legmegfelelőbb megoldásnak. A 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvből „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” néven ismert odaítélési szemponttal való összetévesztését elkerülendő, e fogalom megnevezésére más kifejezést, a „legjobb ár-minőség arány”-t célszerű alkalmazni. Ezt következésképpen az említett irányelvekkel kapcsolatos, vonatkozó ítélkezési gyakorlattal összhangban kell értelmezni, kivéve, ha ezen irányelv ettől egyértelműen jelentősen eltérő megoldást tartalmaz.

(90) A szerződéseket olyan objektív szempontok alapján kell odaítélni, amelyek biztosítják az átláthatóságot, a megkülönböztetésmentességet és az egyenlő bánásmód elvének a betartását ezzel

garantálva az ajánlatok értékének egymással való objektív összehasonlítását annak meghatározása céljából, hogy – a valódi verseny feltételei mellett – melyik a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat. Kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a legjobb ár-minőség arány szempontja alapján kell kiválasztani, amely szempontnak mindig magában kell foglalnia egy ár- vagy költségelemet. Hasonlóképpen egyértelművé kell tenni, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat ezen értékelése elvégezhető kizárólag az ár- vagy a költséghatékonyság alapján is. Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy az ajánlatkérő szervek műszaki leírások vagy szerződésteljesítési feltételek alkalmazásával szabadon határozhatnak meg megfelelő minőségi standardokat. Annak elősegítése érdekében, hogy a közbeszerzés során fokozottan előtérbe kerüljön a minőség, a tagállamok számára engedélyezni kell, hogy – amennyiben ezt megfelelőnek tartják – a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” kiválasztása céljából megtiltsák vagy korlátozzák a kizárólag az ár vagy a költség értékelésén alapuló elbírálást. Annak érdekében, hogy a szerződések odaítélése során érvényesüljön az egyenlő bánásmód elve, az ajánlatkérő szerveket kötelezni kell arra, hogy biztosítsák az ahhoz szükséges átláthatóságot, hogy valamennyi ajánlattevő ésszerűen tájékozódhasson a szerződés odaítélése során alkalmazott szempontokról és szabályokról. Az ajánlatkérő szerveket ezért kötelezni kell arra, hogy megadják az odaítélési szempontokat és az egyes szempontokhoz rendelt relatív súlyozást. Mindazonáltal az ajánlatkérő szervek részére – kellően indokolt esetben, amelyre magyarázatot kell tudniuk adni – engedélyezni kell, hogy ne tüntessék fel az értékelési szempontok súlyozását, amennyiben a súlyozás, különösen a szerződés összetettsége miatt, nem állapítható meg előre. Ilyen esetekben a szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell megadniuk.

(92) A legjobb ár-minőség arány értékelésekor az ajánlatkérő szerveknek meg kell határozniuk, hogy melyek azok a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó gazdasági és minőségi kritériumok, amelyeket e célból alkalmazni fognak. E szempontoknak tehát lehetővé kell tenniük az egyes ajánlatok kínálta teljesítményszintek összehasonlítását a közbeszerzésnek a műszaki leírásban meghatározott tárgya figyelembevételével. A legjobb ár-minőség aránnyal összefüggésben ez az irányelv tartalmazza a lehetséges odaítélési szempontok nem teljes körű, de többek között környezetvédelmi és szociális szempontokat is tartalmazó felsorolását. Az ajánlatkérő szerveket ösztönözni kell az olyan odaítélési szempontok választására, amelyek kiváló minőségű és az igényeiknek a lehető legjobban megfelelő építési beruházások, áruk és szolgáltatások beszerzését teszik lehetővé.

A Kbt. 50. § (2) bekezdés 1) pontja szerint az eljárást megindító felhívásnak tartalmaznia kell az ajánlatok értékelési szempontjait. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozását (kivételesen sorrendjét) is fel kell tüntetni.

(4) Az eljárást megindító felhívásnak és a többi közbeszerzési dokumentumnak minden esetben biztosítani kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be.

A Kbt. 66. § (1) bekezdése szerint az ajánlatot és a részvételi jelentkezést a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

A (2) bekezdés alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

A Kbt. 69. § (1)-(3) bekezdése szerint

(1) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - több szakaszból álló eljárásban a részvételi szakaszban - ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.

A Kbt. 76. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban meghatározni azt a szempontot vagy szempontokat, amelyek alapján a számára - az adott esetben szociális, társadalmi és környezetvédelmi szempontból is - gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kiválasztja (a továbbiakban: értékelési szempontok).

(2) Értékelési szempontként alkalmazhatóak

a) a legalacsonyabb ár,

b) a legalacsonyabb költség, amelyet az ajánlatkérő által meghatározott költséghatékonysági módszer alkalmazásával kell kiszámítani, vagy

c) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.

(3) A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok vonatkozhatnak többek között a minőségre, műszaki értékre, esztétikai és funkcionális tulajdonságokra.

(13) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban olyan előírásokat határoz meg, amelyek biztosítják, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevők által benyújtott információkat ellenőrizni tudja annak megállapítása érdekében, hogy az ajánlat mennyiben felel meg az értékelési szempontoknak. Kétség esetén az ajánlatkérőnek meg kell győződnie az ajánlattevő által benyújtott információk helytállóságáról.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton vagy alszemponton kívüli értékelési szempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban az eljárást megindító felhívásban jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési pontszám felső határával azonos számú pontot ad. Az ajánlatkérő bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.

(4) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

A Kbt. 81. § (1) bekezdése értelmében a nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

(2) A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul.

(11) A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejárától kötve van.

61. A közbeszerzési eljárás célja az, hogy ajánlatkérő a Kbt.-ben meghatározott rendelkezések alapján úgy válassza ki az eljárás eredményeként megkötendő szerződést teljesítő ajánlattevőt, hogy betartsa a Kbt. kógens szabályait, az alapelveket, továbbá a közösségi jog által meghatározott jogi normákat.

A közbeszerzési törvény 2. § (7) bekezdése szerint a törvényben rögzített rendelkezések kógenssek, attól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben azt maga a törvény megengedi.

A Kbt. kógenciájára tekintettel megállapítható, hogy az ajánlatkérőnek a Kbt. 50. §-a szerint kell az eljárást megindító felhívás tartalma tekintetében eljárnia. Ez alapján a felhívást akként kell elkészítenie, hogy az minden esetben biztosítsa, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be.

A közbeszerzés tárgyra, a nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó adatokat, értékelési szempontokat a közbeszerzési dokumentumokban úgy kell megadnia az ajánlatkérőnek, hogy annak alapján a gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni illetve egyértelműen meg tudják állapítani, hogy melyek azok a szempontok, amelyeket a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében az ajánlatkérő vizsgálni fog.

62. A Kbt. kógens szabályai alapján az ajánlatkérő köteles megvizsgálni az általa nevesített értékelési szempontrendszernek való megfelelést, a Kbt. 76. § (13) bekezdése kifejezetten rögzíti, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban olyan előírásokat határoz meg, amelyek biztosítják, hogy az ajánlattevők által benyújtott információkat ellenőrizni tudja annak megállapítása érdekében, hogy az ajánlat mennyiben felel meg az értékelési szempontoknak. Kétség esetén az ajánlatkérőnek meg kell győződnie az ajánlattevő által benyújtott információk helytállóságáról. Ez azt jelenti, hogy minden esetben az ajánlatkérő kötelezettsége az értékelési szempontoknak való megfelelés vizsgálata, ezt helyette nem végezheti el semmilyen szervezet vagy személy. Az ajánlatkérő kötelezettsége továbbá az eljárást lezáró döntés meghozatala. A megalapozott döntést az ajánlatkérőnek kell meghoznia, ezt a Döntőbizottság nem hozhatja meg az ajánlatkérő helyett a jogorvoslati eljárás eredményeképpen.

63. Az ajánlatkérő és az ajánlattevő tekintetében a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőben beáll a kötöttség, az ajánlatkérő az előírásaihoz, az ajánlattevő az ajánlatához kötve van.

Ez olyan garanciális szabály, amely alapvető az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében, mivel ettől az időponttól kezdődően az ajánlatkérő csak azt kérheti számon az ajánlattevőktől, amit a felhívásában, dokumentációjában, adott esetben a kiegészítő tájékoztatásában meghatározott. Ezeket az elvárásokat azonban köteles számon kérni és adott esetben meg kell győződnie azok helytállóságáról.

64. A fentiekben hivatkozottak alapján a Döntőbizottság a konkrét közbeszerzési eljárás adatai alapján az 1-3. kérelmi elemek tekintetében azonosan a következőket állapította meg. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásában az értékelési szempontrendszerében több minőségi és egyben funkcionális tulajdonságot kívánt értékelni a nyertes ajánlattevő személye kiválasztása körében. A jogorvoslati eljárásban vizsgált 3.2., 3.5. és 3.7. alszempontok szerinti funkcionális tulajdonságok vállalása során az ajánlattevőknek egyrészt konkrét értéket kellett megadniuk illetve bizonyos funkcionális tulajdonságok meglétéről kellett nyilatkozniuk. Az

ajánlatkérő e körben a közbeszerzési dokumentumokban semmilyen alátámasztó dokumentum benyújtását nem kérte, a vállalat körében nyilatkozni kellett annak meglétéről. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 3. részében a döntése meghozatalakor elfogadta az ajánlattevők ajánlati nyilatkozatait a vizsgált értékelési részszerzőpontoknak való megfelelést tekintve.

65. A kérelmező az ajánlatkérő ezen döntése ellen előzetes vitát kezdeményezett, mely során az ajánlatkérő felvilágosítást kért az egyéb érdekelttől a kérelmező által megfogalmazottak közlésével. Az egyéb érdekelt a feltett kérdésekre megadta a választ, amely nem tartalmazott semmilyen lényegi alátámasztást a megajánlás vonatkozásában. Az ajánlatkérő az egyéb érdekelt választát elfogadta és elutasította az előzetes vitarendezési kérelmet.

66. A jogorvoslati eljárásban a kérelmező további adatokkal, tényekkel, hivatkozásokkal támasztotta alá az ajánlatkérői döntés megalapozatlanságát tartalmazó kérelmét, amely körében az ajánlatkérő és az egyéb érdekelt is nyilatkozatot tett, majd erre a kérelmező további adatokra hivatkozva továbbra is vitatta az egyéb érdekelt által vállalt megajánlás tartalmát.

67. A fentiek alapján a Döntőbizottság azt állapította meg, hogy az ajánlatkérő közbeszerzési eljárás 3. részében meghozott döntése az értékelés körében nem volt megalapozott. A jogorvoslati eljárás adatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlatkérő az egyéb érdekelt kifogásolt részszerzőpontokra adott vállalatát nem vizsgálta meg a megalapozott döntéshez szükséges mélységben, és a kérelmező által az előzetes vitarendezés során felvetett kifogásokat sem vizsgálta meg megfelelően.

68. Az ajánlatkérő kötelezettsége, hogy a felmerült kétség esetén győződjön meg az ajánlattevő által benyújtott információk helytállóságáról. A jogorvoslati eljárás során egyértelműen kétségek merültek fel az egyéb érdekelt vizsgált értékelési részszerzőpontok körében adott vállalatát tekintetében, hogy azok megfelelnek-e az ajánlatkérői előírásoknak. Az ajánlatkérő a kérelmei elemek alapján nem győződött meg arról, hogy a nyertesnek nyilvánított ajánlatban a 3.2. értékelési részszerzőpont körében a megajánlott eszköz képes-e a megajánlottak szerint 30 KV gyorsítófeszültség mellett az 1 nm képfelbontásra. A rendelkezésre álló adatok szerint az ajánlatkérő a 3.5 értékelési részszerzőpontnál sem vizsgálta meg az elvártaknak megfelelően, hogy a megajánlott eszköz azonnali pontelemzésre képe-se a szekunder és visszaszórt élő képen második szoftver megnyitása nélkül illetve arról sem, hogy folyamatos nagyításra képes-e az eszköz optikai képről (pl. navigációs kép) elektronmikroszkópos képig egy gomb használatával. Az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia az egyéb érdekelt hivatkozott vállalatát abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e az értékelési részszerzőpontokban előírt elvárásoknak, e körében tételesen meg kell vizsgálnia azokat a kifogásokat, amelyeket a kérelmező felhozott a jogorvoslati eljárásban. Az ajánlatkérő csak az objektív adatokkal alátámasztott vállalatokat fogadhatja el. Az ajánlatkérő ezen vizsgálat elvégzését követően lesz abban a helyzetben, hogy a közbeszerzési eljárás 3. részében megalapozott döntést hozhasson és előírásának megfelelő pontozást alkalmazva válassza ki a nyertes ajánlattevőt.

69. A Döntőbizottság a Kbt. 144. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a – fenti indokokra tekintettel – a Kbt. 165. § (2) bekezdés d) pontja alapján megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a jogorvoslati kérelem mindhárom eleme vonatkozásában a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésére és a 77. § (4) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (3)

bekezdését, ezért az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása 3. részét lezáró döntését megsemmisítette és bírságot szabott ki.

70. A Kbt. 165. § (4) bekezdés értelmében a (3) bekezdés d) pontja szerinti bírság összege – a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a közbeszerzési eljárás becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének legfeljebb 10%-a.

Az (5) bekezdés rögzíti, hogy ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben előzetes vitarendezést kezdeményeztek és az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját megküldte, de egyéb intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében a (3) bekezdés d) pontja szerinti bírság összege – a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a közbeszerzési eljárás becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének legfeljebb 15 %-a.

A (11) bekezdés alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, valamint a bírság összegének, illetve az eltiltás időtartamának megállapításában az eset összes körülményét – így különösen a jogsértés súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek az eljárást segítő az eljárást segítő együttműködő magatartását, a jogsértés megtörténte és a jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt hosszú időtartamot, támogatásból megvalósult beszerzés esetén azt a körülményt, ha a jogsértéshez más szerv eljárásban a támogatás visszafizetésére vonatkozó szankció kapcsolódhat – figyelembe veszi. A bírság összegének és az eltiltás időtartamának megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.

71. A Döntőbizottság a bírság kiszabását indokoltnak tartotta, mivel az ajánlatkérő súlyos jogsértést követett el azzal, hogy nem vizsgálta meg kellő mélységben a kérelmező előzetes vitarendezési kérelmében írtak ellenére sem az egyéb érdekelt által a vizsgált értékelési részszempontra adott vállalás tartalmát és felmerült kétség ellenére nem végzett tényleges érdemi vizsgálatot e körben. A Döntőbizottság a bírság kiszabásának körében figyelembe vette továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás 3. részét lezáró döntés megsemmisítésével a jogsérelem reparálható.

A Döntőbizottság figyelembe vette azt is, hogy az ajánlatkérő jogsértő eljárása egyértelmű kihatással volt az eljárást lezáró döntésre, továbbá azt is, hogy az ajánlatkérő a pártázó elektronmikroszkópot olyan Magyarországon és az Európai Unióban is jelentős innovációs tevékenységéhez szerzi be, mely előremutató a vízgazdálkodás területén.

A Döntőbizottság figyelembe vette a közbeszerzési eljárás értékét (59.913.333.-Ft), illetve hogy a támogatásból megvalósult beszerzés esetén azt a körülményt, ha a jogsértéshez más szerv eljárásban a támogatás visszafizetésére vonatkozó szankció kapcsolódhat.

A törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítása körében a Döntőbizottság figyelembe vette a D.30/2017., a D.813/2016., a D.695/16., a D.152/2016. számú jogorvoslati eljárásokban az ajánlatkérővel szemben jogsértés megállapítására és bírság kiszabására sor került.

Azt is figyelembe vette a Döntőbizottság, hogy az ajánlatkérő az eljárást segítő együttműködő magatartás körében a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek tett eleget, jogait gyakorolta, ezeken túli együttműködő magatartást nem tanúsított.

A fentiekben felsorolt indokok alapján a Döntőbizottság a rendelkező részben nevesített bírság kiszabását tartotta indokoltnak.

72. Az eljárási költség összegét a Döntőbizottság a következőkre figyelemmel állapította meg a rendelkező részben meghatározottak szerint.

A kérelmező 299.567.-Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg.
A Döntőbizottság a kérelmező jogorvoslati kérelmének helyt adott.

A Kbt. 151. § (9) bekezdése alapján, ha a jogorvoslati ügyet lezáró érdemi határozatban a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 165. § (2) bekezdés c)-f) pontja szerinti döntést hoz, a befizetett igazgatási szolgáltatási díj háromezer forintot meghaladó része a kérelmezőnek a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának megküldését követő 8 napon belül visszajár. Az igazgatási szolgáltatási díj összegéből háromezer forint ilyenkor is a Közbeszerzési Hatóság saját bevétele, amelynek viseléséről a Közbeszerzési Döntőbizottság az Ákr. szerint az eljárási költségekre vonatkozó általános szabályok szerint rendelkezik. Az alaptalan kérelem esetében a díj nem kerül visszatérítésre, a kérelmező viseli az igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét.

A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 2. § (1)-(3) bekezdései szerint:

(1) A Közbeszerzési Döntőbizottság az ügy érdemében hozott határozatában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 129. § (1) bekezdésétől eltérően az eljárási költségekről való döntés keretében az igazgatási szolgáltatási díjról a (2)-(3) bekezdés szerint rendelkezik.

(2) Amennyiben a jogorvoslati ügyet lezáró érdemi határozatban a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 165. § (2) bekezdés c)-f) pontja szerinti döntéseket hoz, a befizetett igazgatási szolgáltatási díj 200 000 forintot meghaladó része a kérelmezőnek a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának megküldését követő 8 napon belül visszajár. Az igazgatási szolgáltatási díj összegéből 200 000 forint ilyenkor is a Közbeszerzési Hatóság saját bevétele, amelynek viseléséről a Közbeszerzési Döntőbizottság az Ákr. szerint az eljárási költségekre vonatkozó általános szabályok szerint rendelkezik. Az alaptalan kérelem esetében a díj nem kerül visszatérítésre, a kérelmező viseli az igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét.

(3) Amennyiben a kérelmező jogorvoslati kérelmében több jogsértés megállapítását is kérte, de a Közbeszerzési Döntőbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a kérelemnek csak részben ad helyt, az igazgatási szolgáltatási díjnak a Közbeszerzési Hatóság (2) bekezdés szerinti saját bevételeivel csökkentett részét az alapos és alaptalan kérelmek arányának figyelembevételével téríti vissza a kérelmezőnek.

A kérelmező alapos jogorvoslati kérelmére ellenére a Döntőbizottság nem rendelkezett azt igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről, mivel a megfizetett igazgatási szolgáltatás díj mértéke ezt nem tette lehetővé.

Az ajánlatkérőt érintő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére és az eljárás során felmerült költségek viselésére vonatkozó kötelezés a 45/2015. MvM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 129. § (1) bekezdésétől eltérően a (2)-(3) bekezdésen alapul.

A határozat közigazgatási perben történő elbírálását a Kbt. 170. §-a biztosítja.

A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat közigazgatási perben történő felülvizsgálatára a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (2) bekezdés a) pontja és a 13. § (11) bekezdése szerint a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

A jogi képviselőt a Kp. 27. § (1) bekezdése alapján kötelező. A kereseti kérelem elektronikus úton történő benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján kötelező.

A Döntőbizottság hatásköre és illetékessége a Kbt. 145. § (2)-(5) bekezdésein alapul.

B u d a p e s t, 2018. december 10.

Dr. Dajka Gabriella sk.
közbeszerzési biztos

Gulyás Richárd sk.
közbeszerzési biztos

Dr. Horváth Éva sk.
közbeszerzési biztos

A kiadmány hitelül:

Tóth Zoltánné
titkárságvezető

Kapják:

1. Dr. Dull Attila felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (KRID: 643720908)
2. Dr. Zámbo Balázs jogtanácsos (KRID: 643720908)
3. Dr. Orosz Dániel ügyvéd (KRID: 18137020)
4. Image-Science Kft. (KRID: 25801042)
5. Auro-Science Consulting Kft. (KRID: 10483592)
6. Közbeszerzési Hatóság Titkársága (Helyben)